

リニアレギュレータシリーズ

# BAxxCC0 シリーズ 特性データ

No.AEK59-D1-0055-1

## リスト

BA03CC0 ( $V_O=3.0V$ ) .....	2
BA033CC0 ( $V_O=3.3V$ ) .....	6
BA05CC0 ( $V_O=5.0V$ ) .....	10
BA06CC0 ( $V_O=6.0V$ ) .....	14
BA07CC0 ( $V_O=7.0V$ ) .....	18
BA08CC0 ( $V_O=8.0V$ ) .....	22
BA09CC0 ( $V_O=9.0V$ ) .....	26
BAJ0CC0 ( $V_O=10V$ ) .....	30
BAJ2CC0 ( $V_O=12V$ ) .....	34
BAJ5CC0 ( $V_O=15V$ ) .....	38
測定回路図 .....	42

BA03CC0 ( $V_o=3.0V$ )

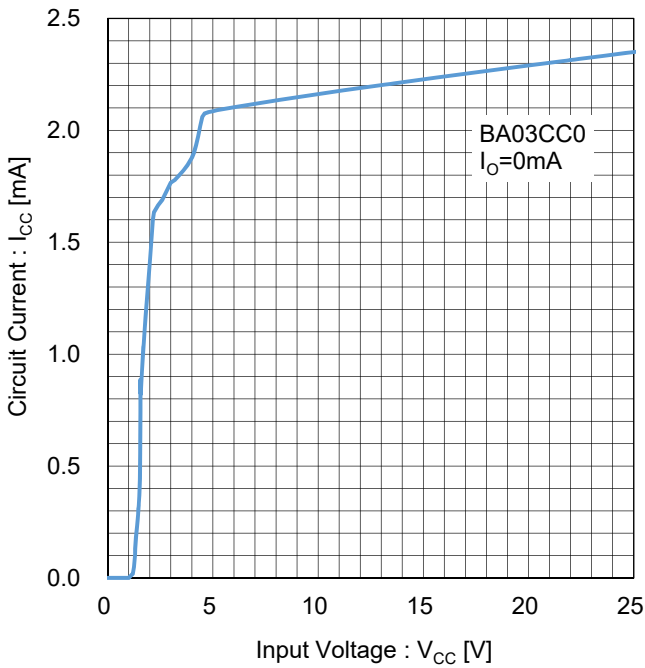


Figure 1. 回路電流  
Test Circuit A

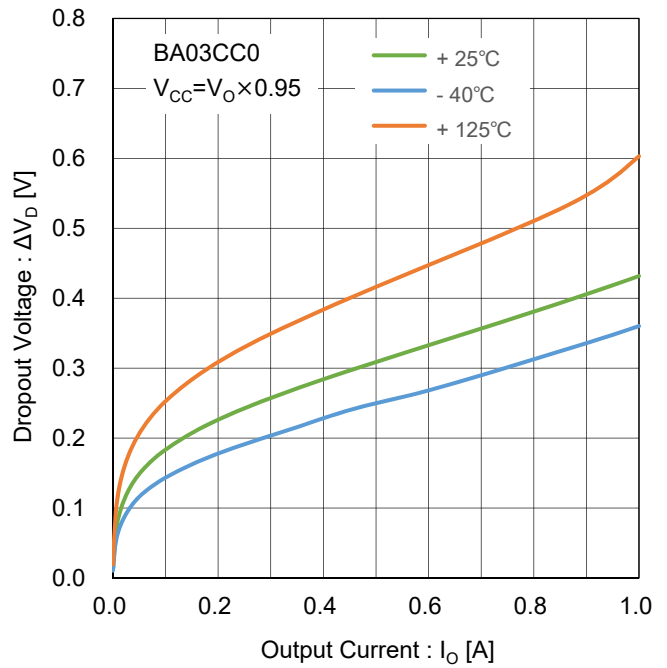


Figure 2. 最小入出力電圧差 vs 出力電流  
Test Circuit B

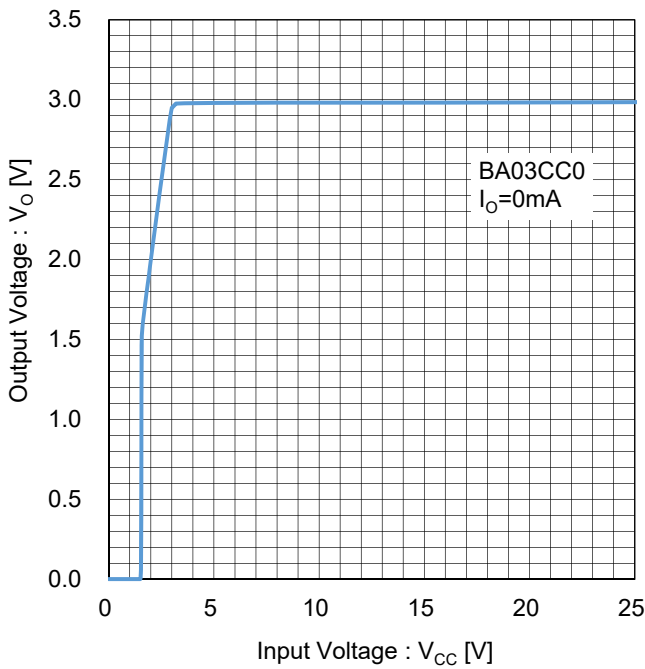


Figure 3. 出力電圧 vs 入力電圧  
( $I_o=0mA$ )  
Test Circuit C

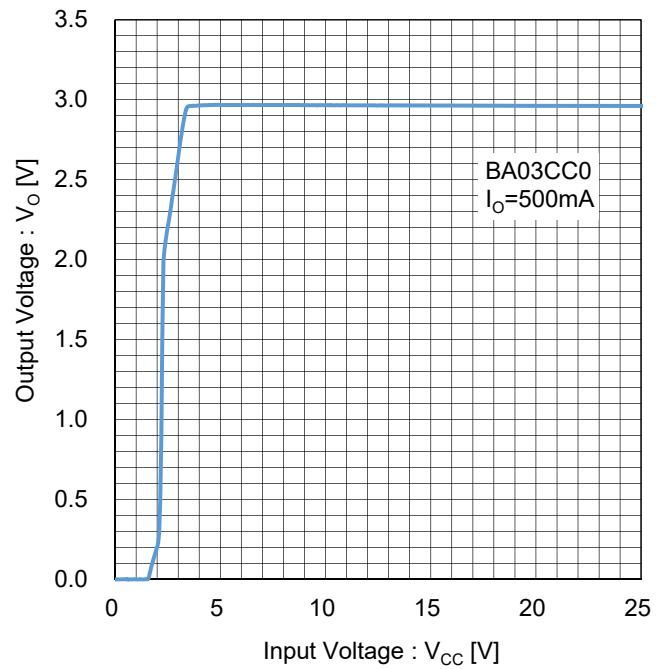


Figure 4. 出力電圧 vs 入力電圧  
( $I_o=500mA$ )  
Test Circuit C

BA03CC0 ( $V_O=3.0V$ )

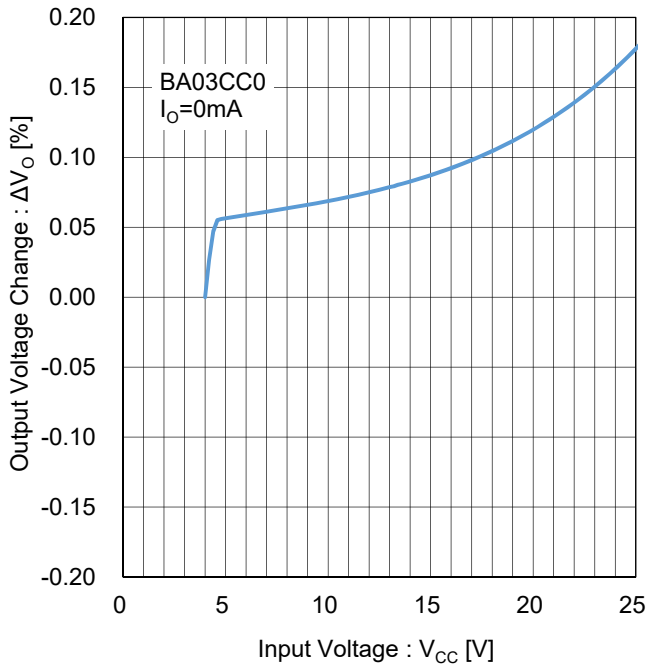


Figure 5. ラインレギュレーション  
( $I_o=0mA$ )  
Test Circuit D

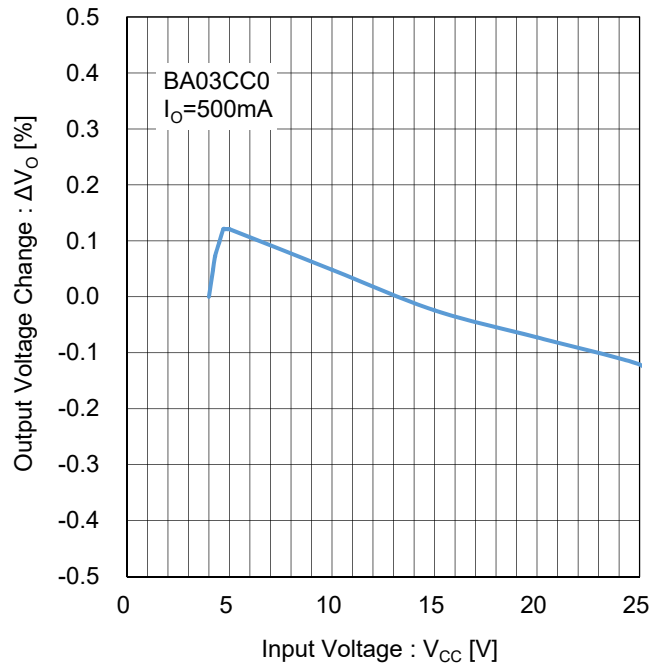


Figure 6. ラインレギュレーション  
( $I_o=500mA$ )  
Test Circuit D

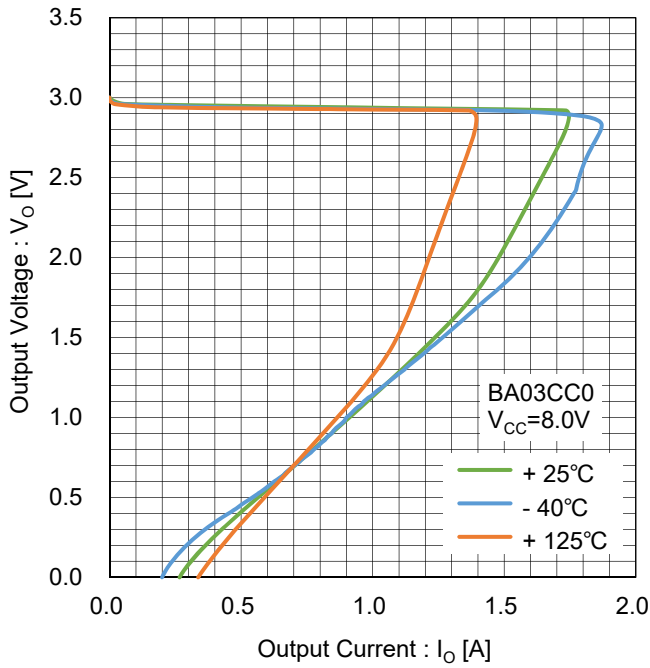


Figure 7. 過電流保護  
Test Circuit E

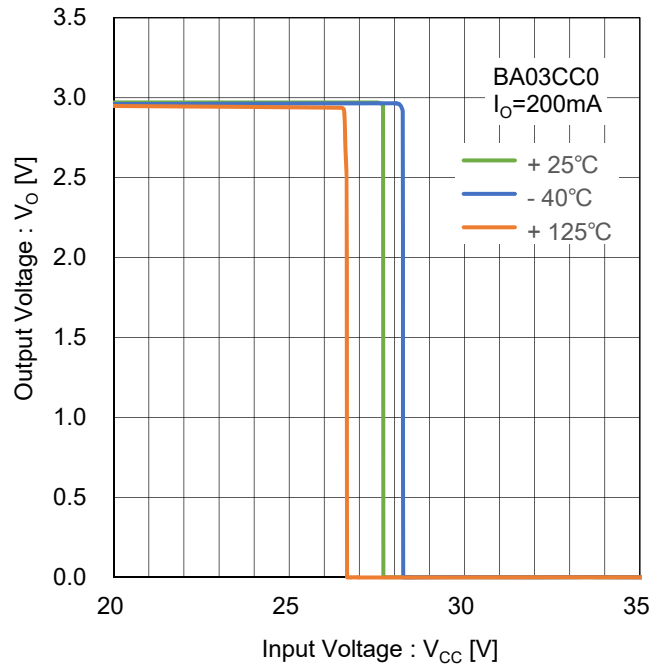


Figure 8. 過電圧動作  
Test Circuit F

BA03CC0 ( $V_O=3.0V$ )

BA033CC0 のデータを参照

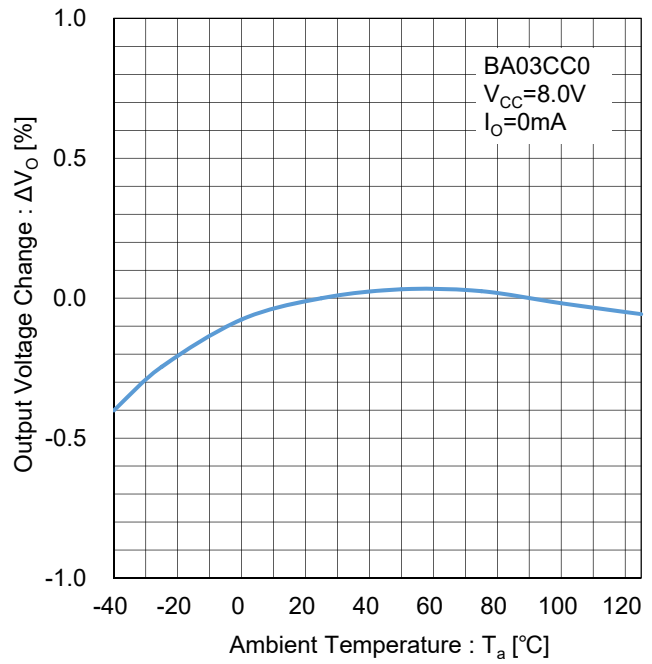


Figure 9. リップルリジェクション  
Test Circuit G

Figure 10. 出力電圧温度安定性  
Test Circuit H

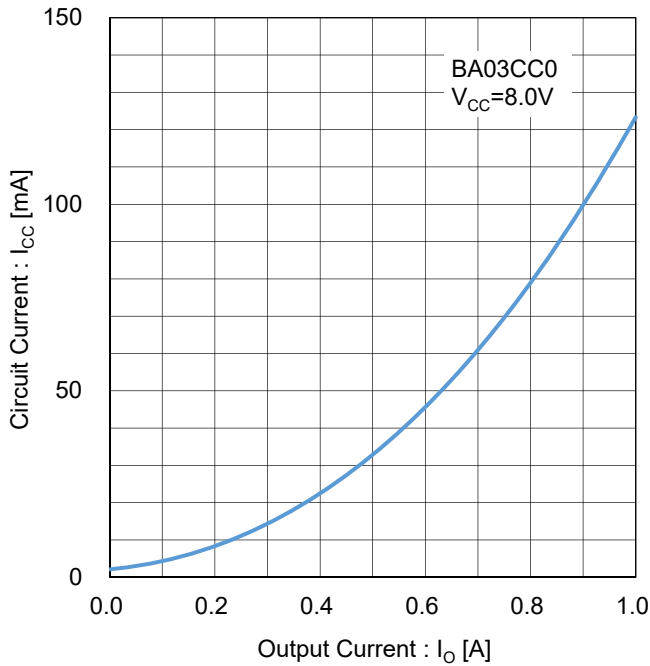


Figure 11. 回路電流 vs 出力電流  
Test Circuit I

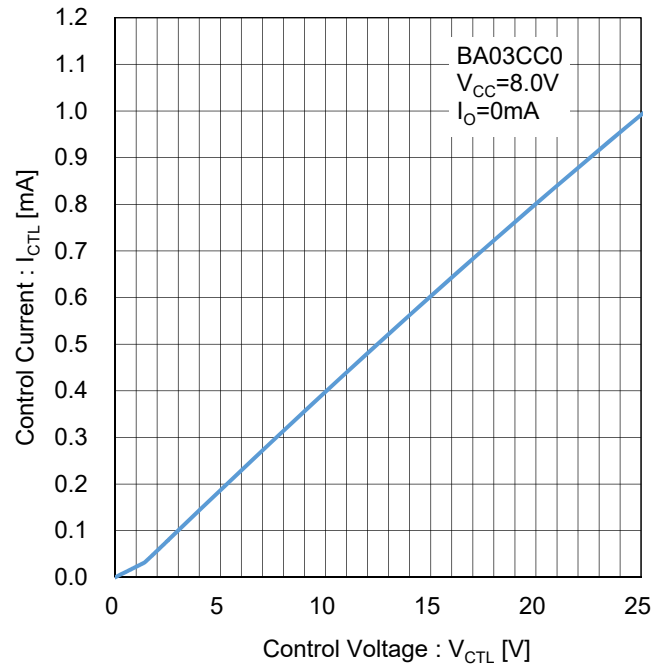


Figure 12. CTLピン流入電流  
Test Circuit J

BA03CC0 ( $V_o=3.0V$ )

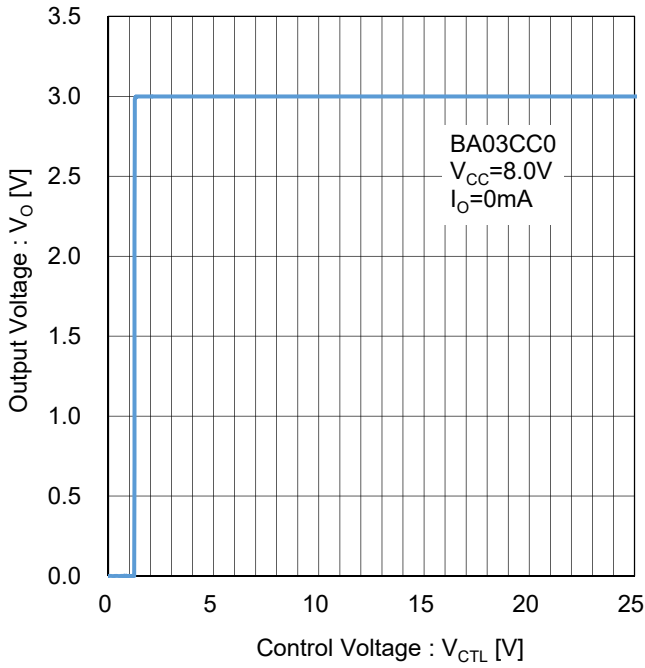


Figure 13. 出力電圧 vs CTL ピン電圧  
Test Circuit K

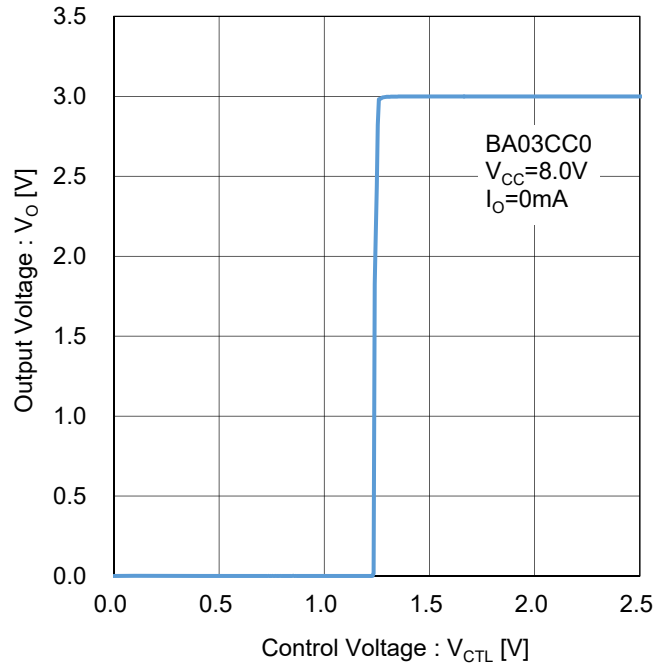


Figure 14. 出力電圧 vs CTL ピン電圧  
Test Circuit K

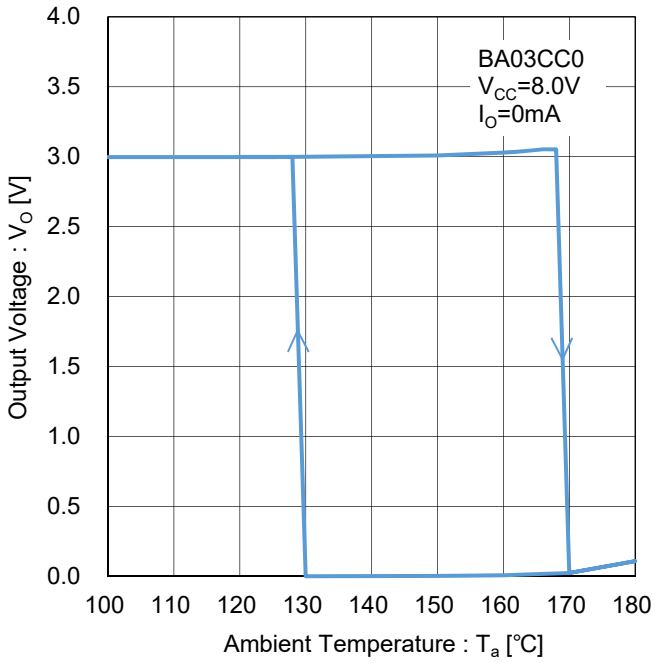


Figure 15. 過熱保護  
Test Circuit L

BA033CC0 ( $V_O=3.3V$ )

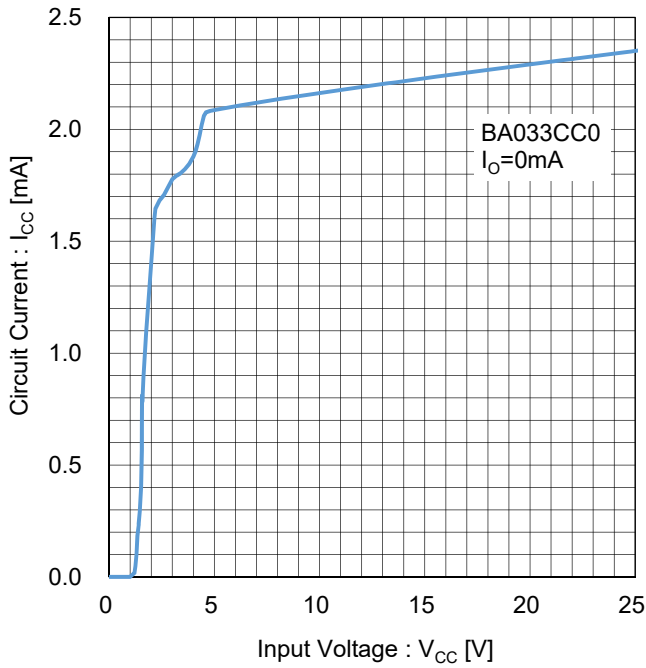


Figure 16. 回路電流  
Test Circuit A

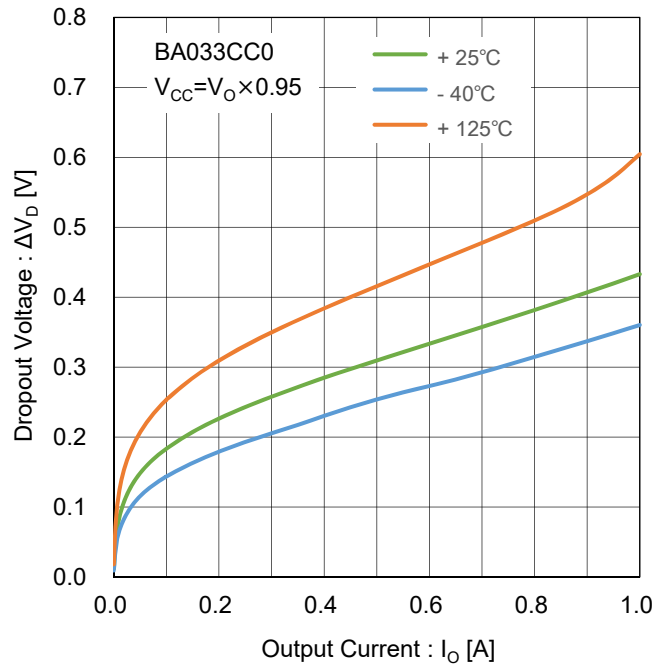


Figure 17. 最小入出力電圧差 vs 出力電流  
Test Circuit B

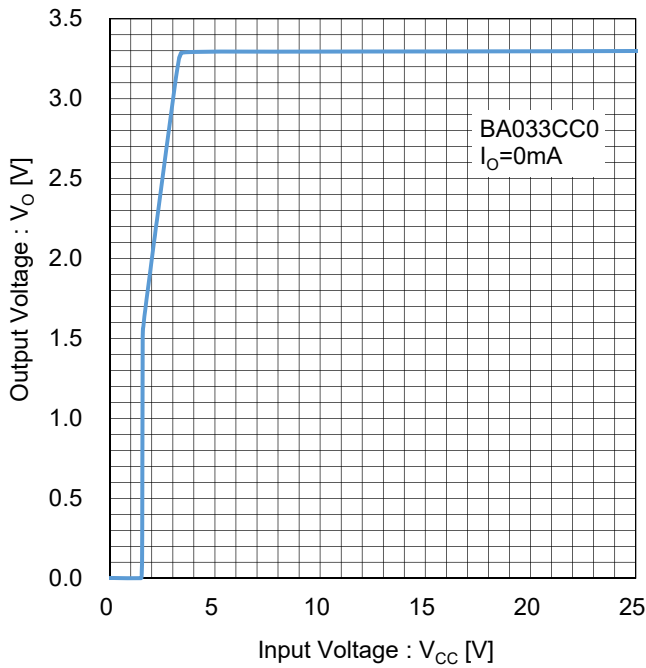


Figure 18. 出力電圧 vs 入力電圧  
( $I_O=0mA$ )  
Test Circuit C

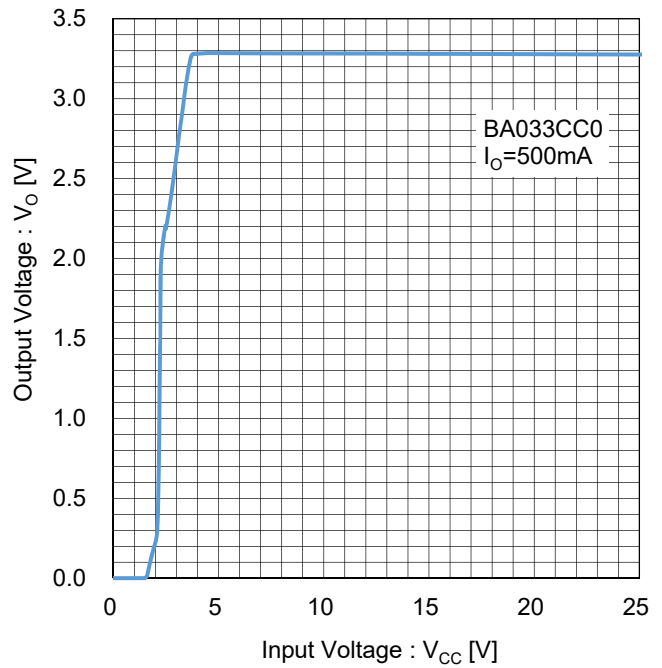


Figure 19. 出力電圧 vs 入力電圧  
( $I_O=500mA$ )  
Test Circuit C

BA033CC0 ( $V_o=3.3V$ )

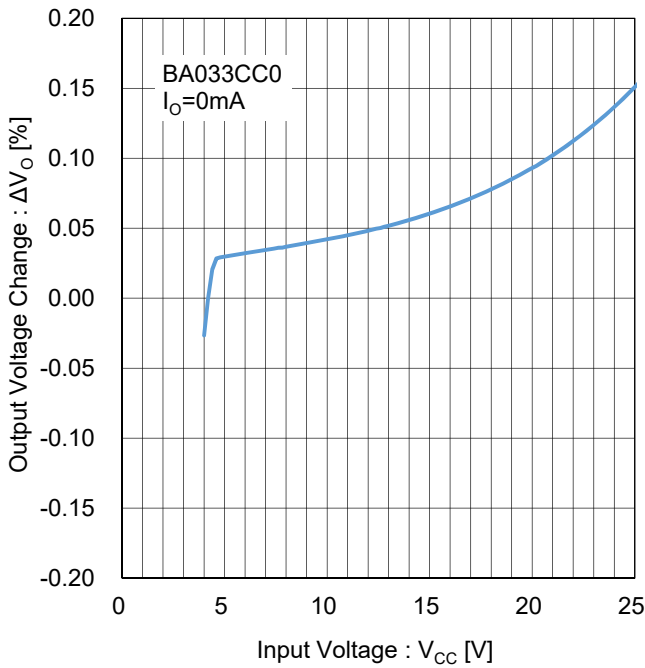


Figure 20. ラインレギュレーション  
( $I_o=0mA$ )  
Test Circuit D

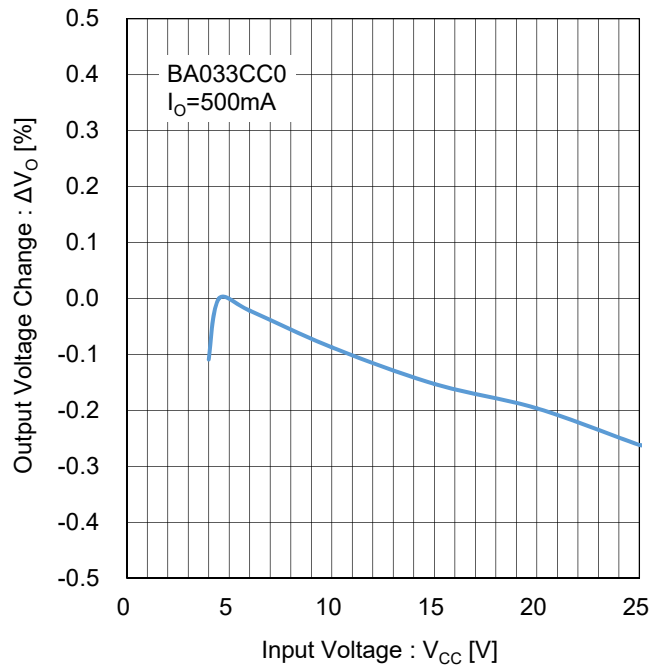


Figure 21. ラインレギュレーション  
( $I_o=500mA$ )  
Test Circuit D

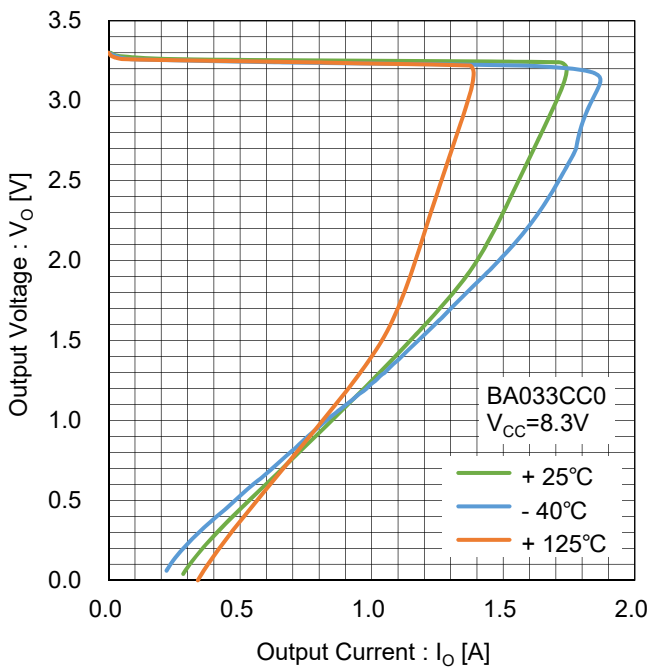


Figure 22. 過電流保護  
Test Circuit E

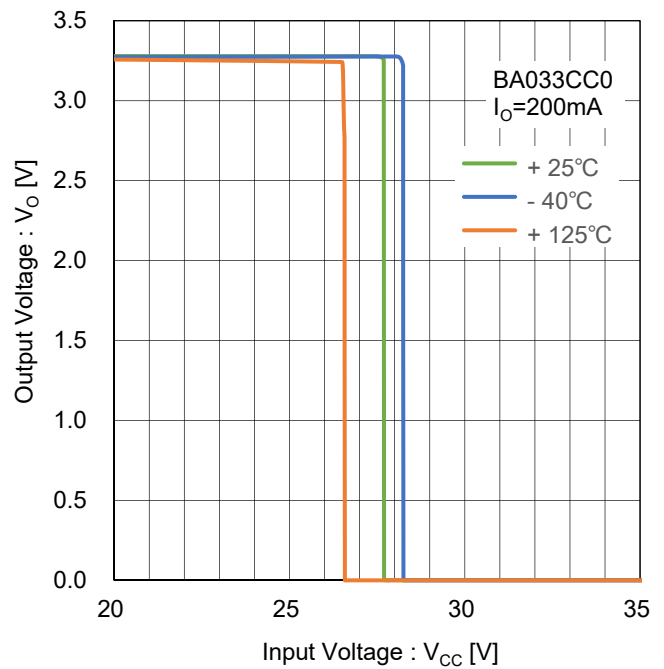


Figure 23. 過電圧動作  
Test Circuit F

BA033CC0 ( $V_o=3.3V$ )

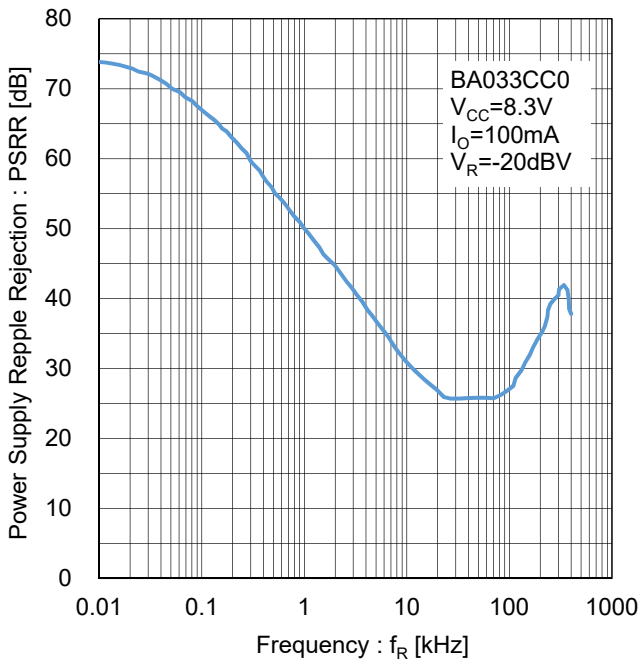


Figure 24. リップルリジェクション  
Test Circuit G

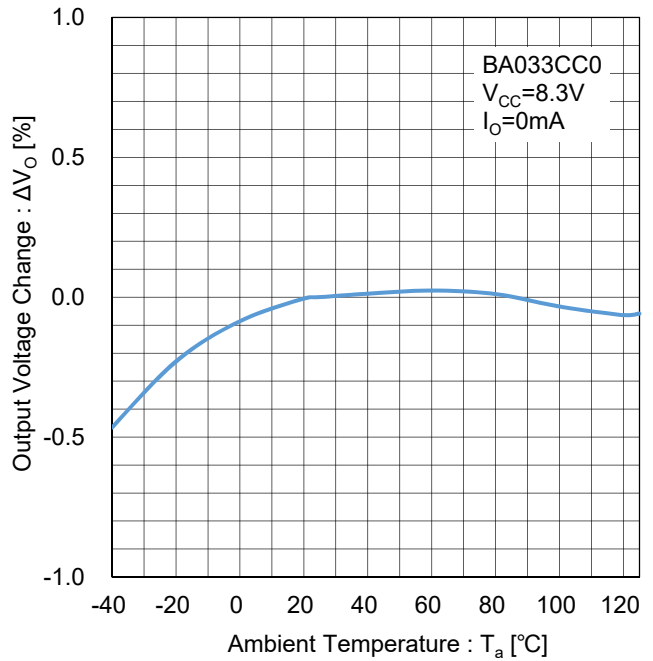


Figure 25. 出力電圧温度安定性  
Test Circuit H

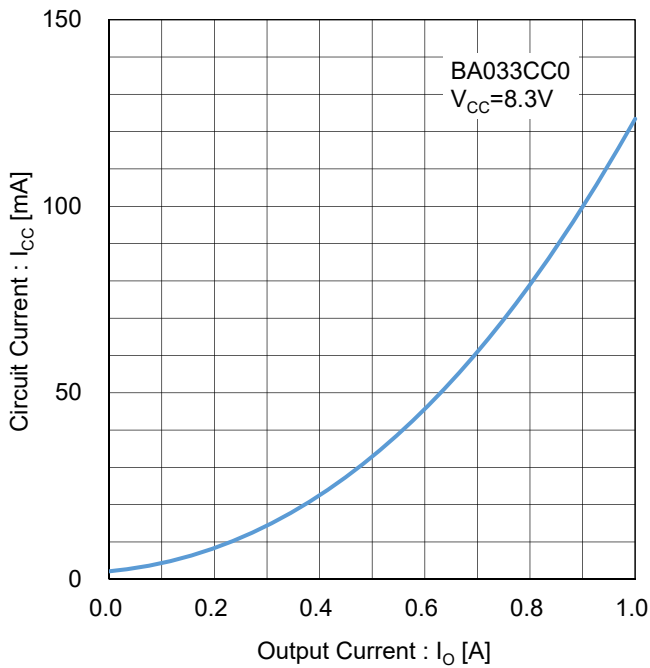


Figure 26. 回路電流 vs 出力電流  
Test Circuit I

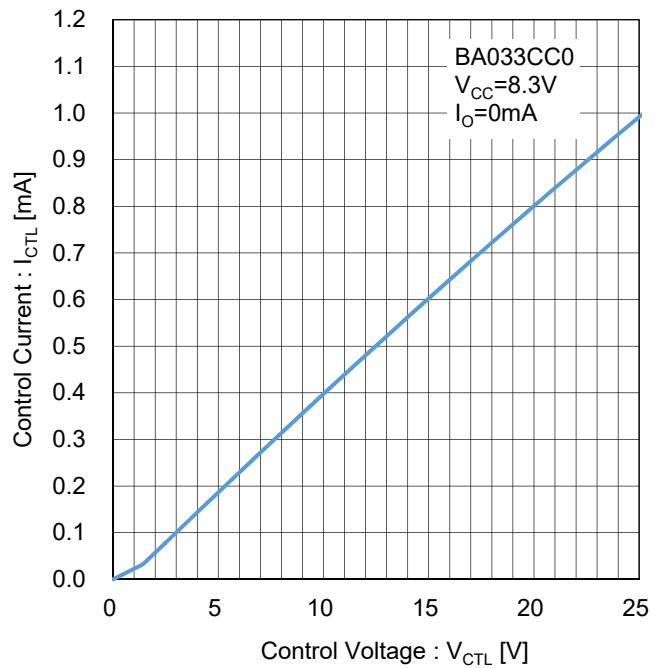


Figure 27. CTLピン流入電流  
Test Circuit J



BA033CC0 ( $V_o=3.3V$ )

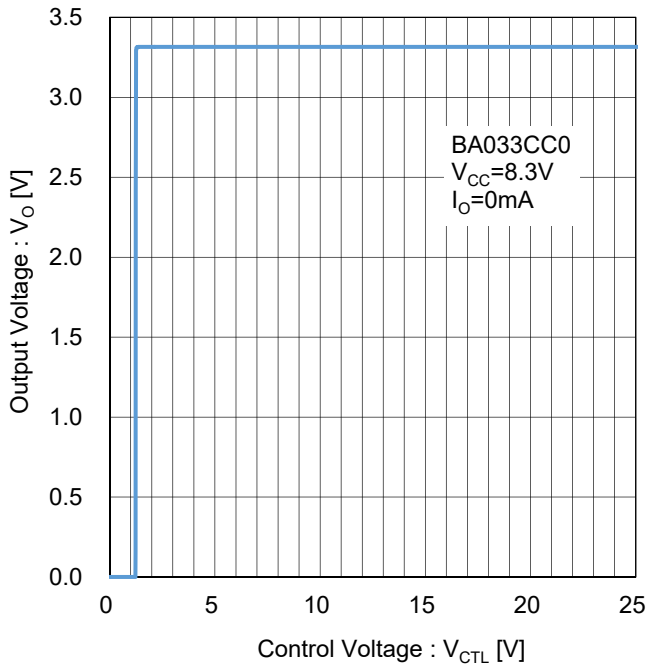


Figure 28. 出力電圧 vs CTL ピン電圧  
Test Circuit K

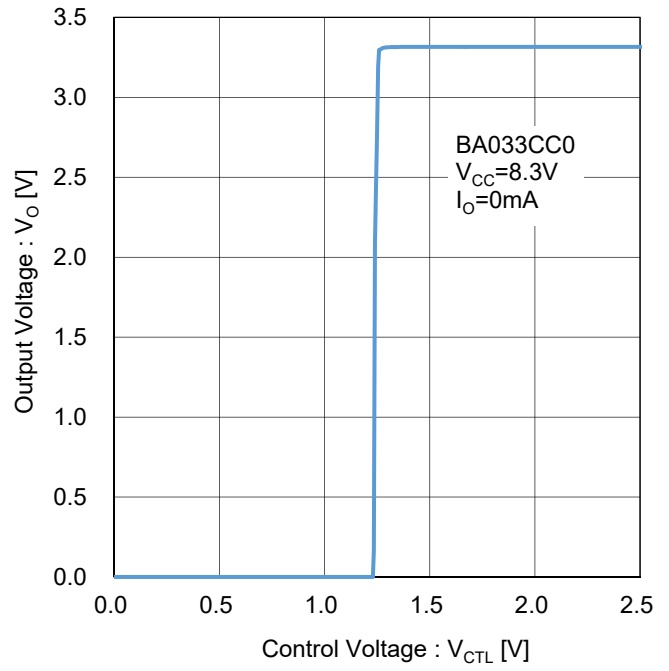


Figure 29. 出力電圧 vs CTL ピン電圧  
Test Circuit K

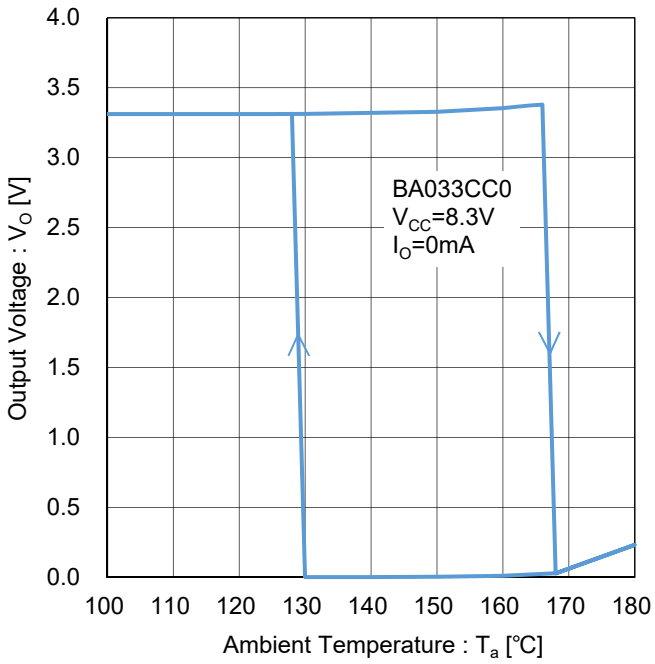


Figure 30. 過熱保護  
Test Circuit L

BA05CC0 ( $V_o=5.0V$ )

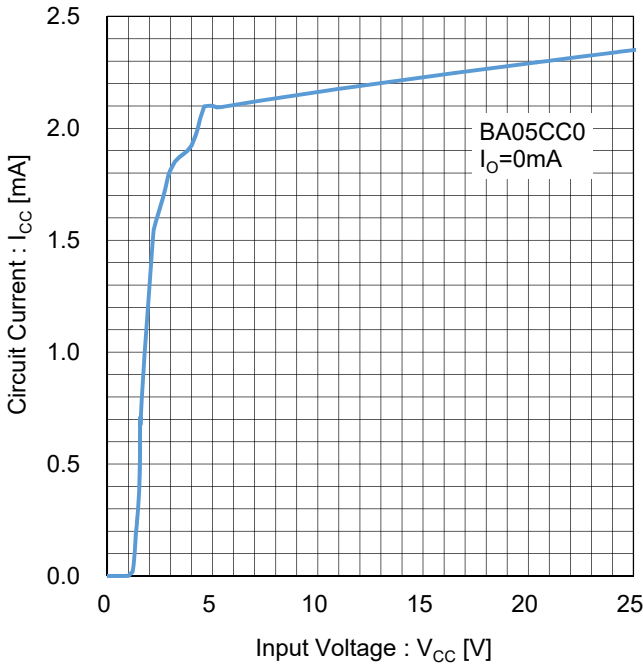


Figure 31. 回路電流  
Test Circuit A

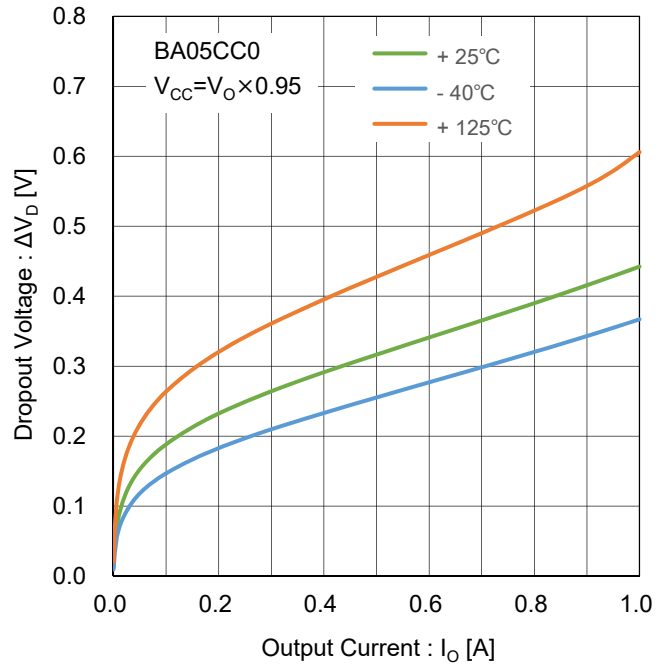


Figure 32. 最小入出力電圧差 vs 出力電流  
Test Circuit B

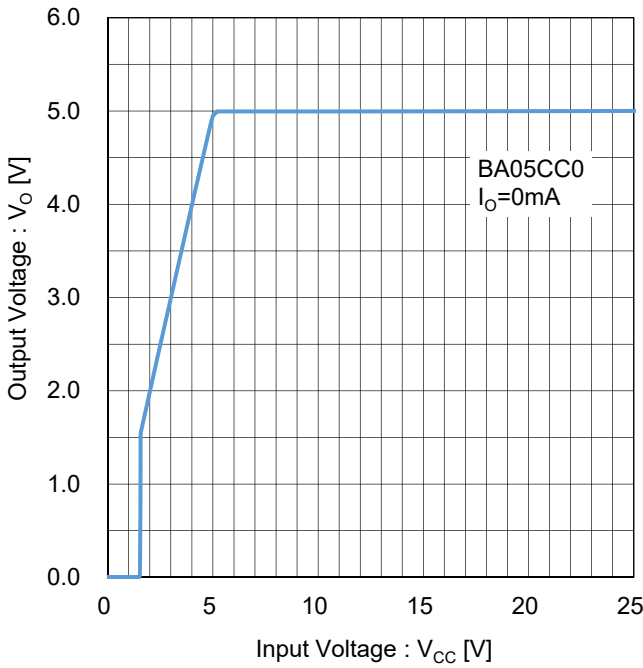


Figure 33. 出力電圧 vs 入力電圧  
( $I_o=0mA$ )  
Test Circuit C

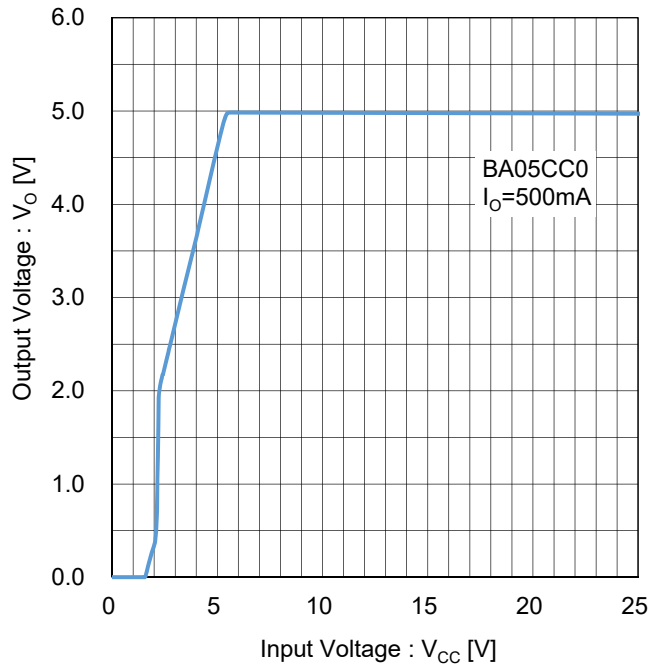


Figure 34. 出力電圧 vs 入力電圧  
( $I_o=500mA$ )  
Test Circuit C

BA05CC0 ( $V_O=5.0V$ )

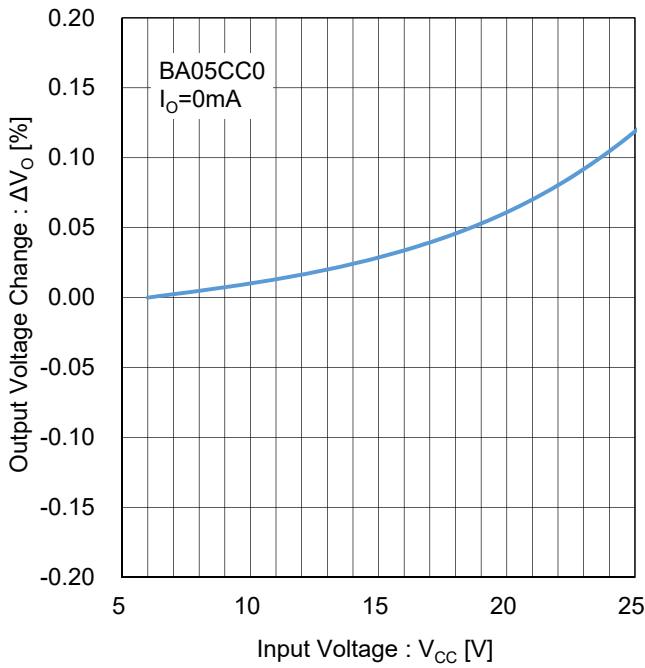


Figure 35. ラインレギュレーション  
( $I_o=0mA$ )  
Test Circuit D

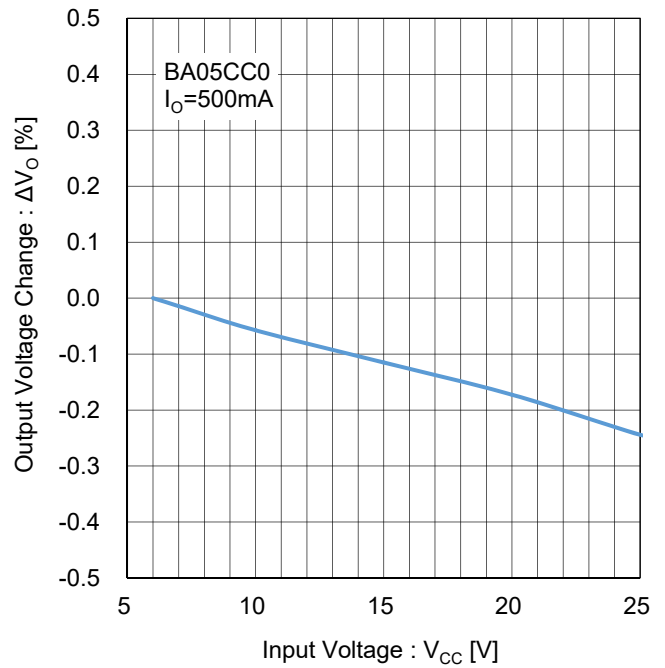


Figure 36. ラインレギュレーション  
( $I_o=500mA$ )  
Test Circuit D

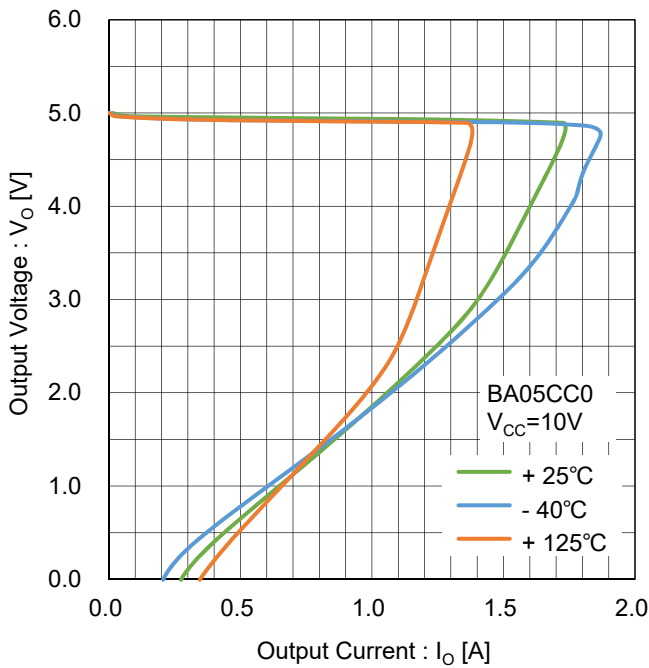


Figure 37. 過電流保護  
Test Circuit E

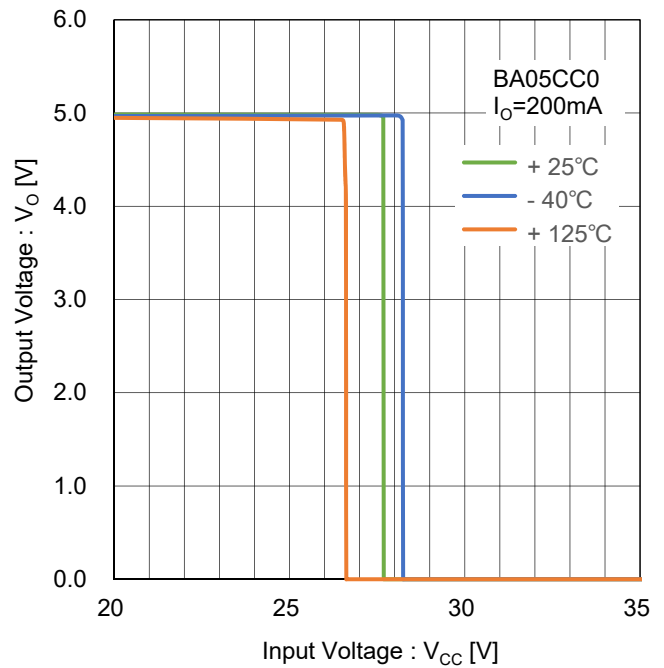


Figure 38. 過電圧動作  
Test Circuit F

BA05CC0 ( $V_o=5.0V$ )

BA033CC0 のデータを参照

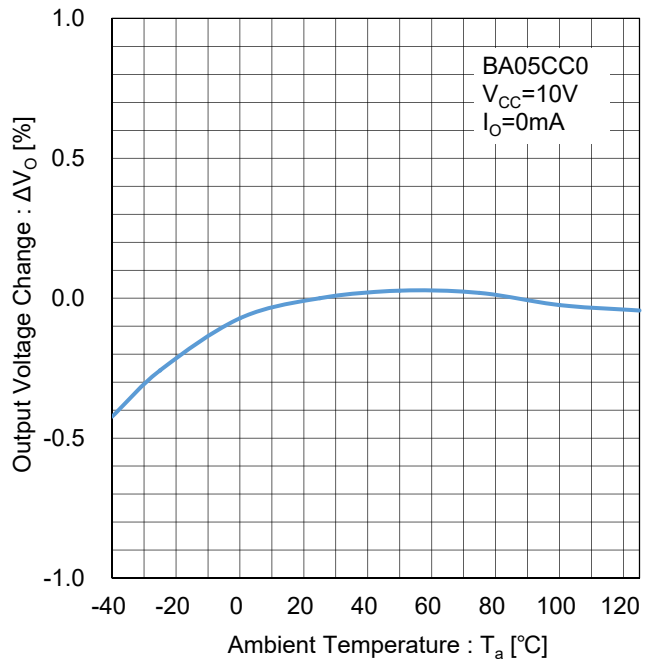


Figure 40. 出力電圧温度安定性  
Test Circuit H

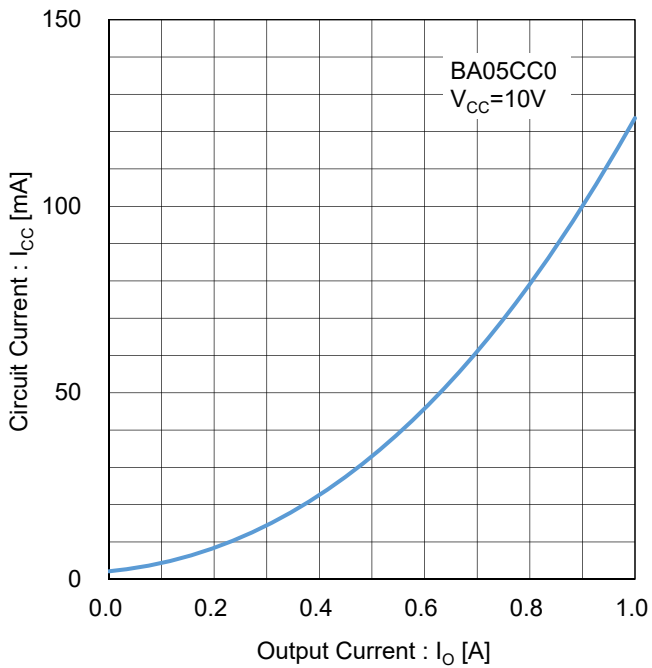


Figure 41. 回路電流 vs 出力電流  
Test Circuit I

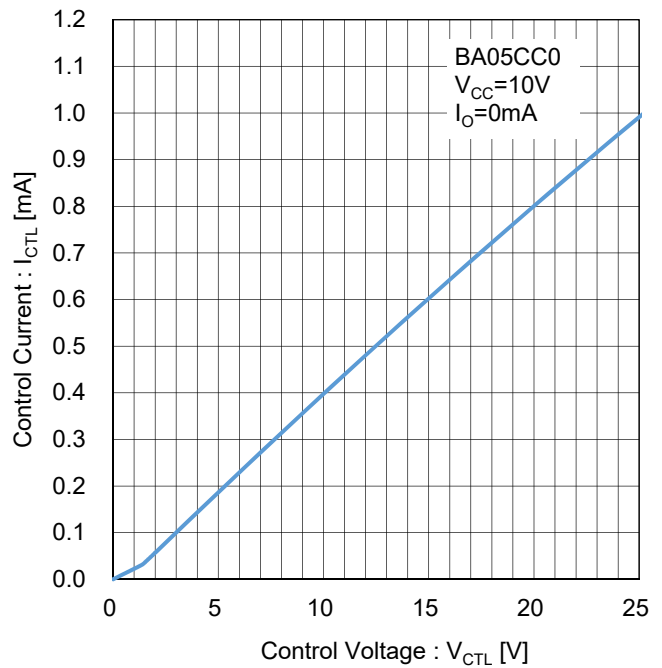


Figure 42. CTLピン流入電流  
Test Circuit J

BA05CC0 ( $V_o=5.0V$ )

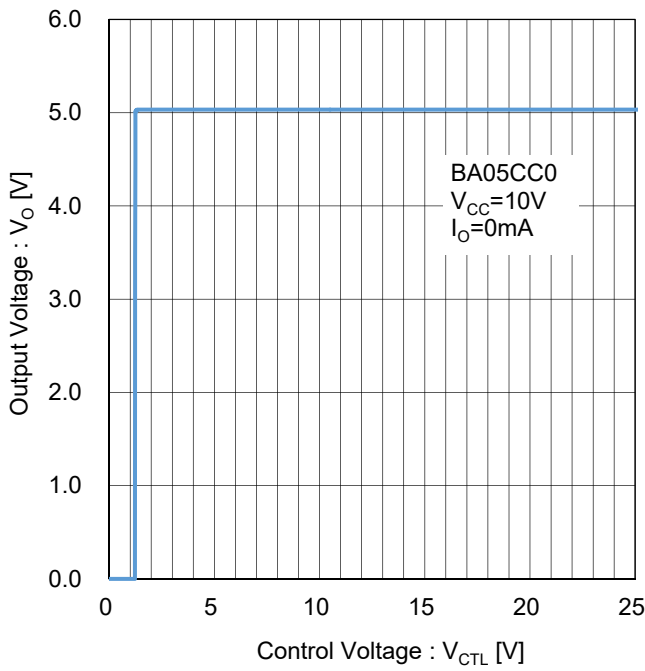


Figure 43. 出力電圧 vs CTL ピン電圧  
Test Circuit K

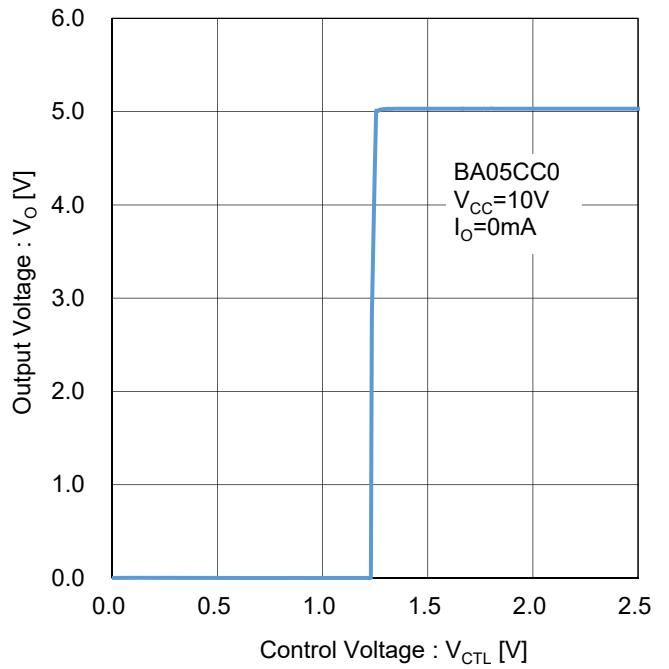


Figure 44. 出力電圧 vs CTL ピン電圧  
Test Circuit K

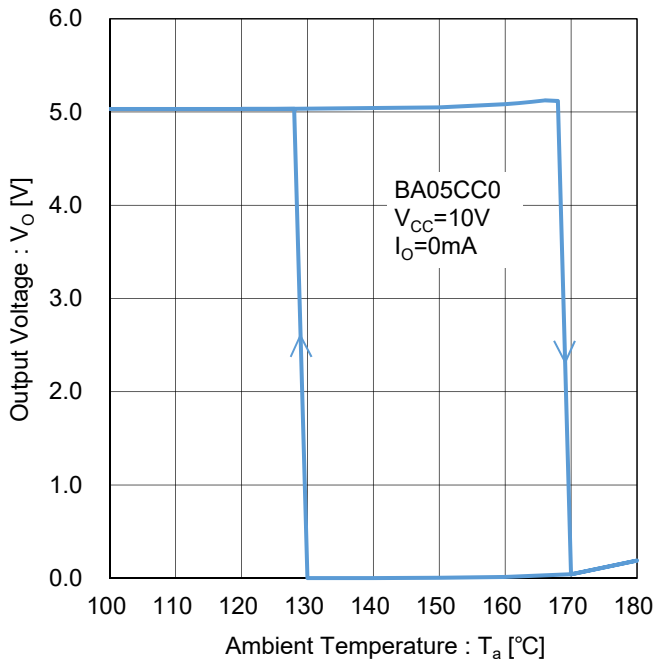


Figure 45. 過熱保護  
Test Circuit L

BA06CC0 ( $V_o=6.0V$ )

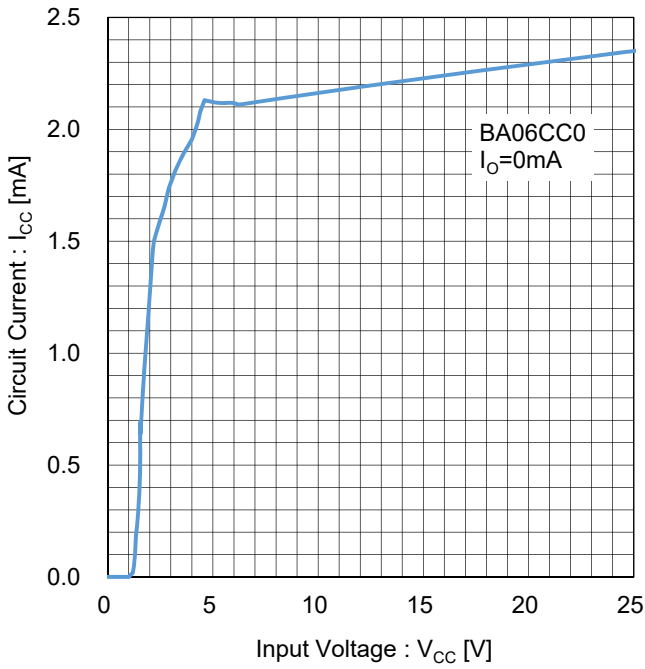


Figure 46. 回路電流  
Test Circuit A

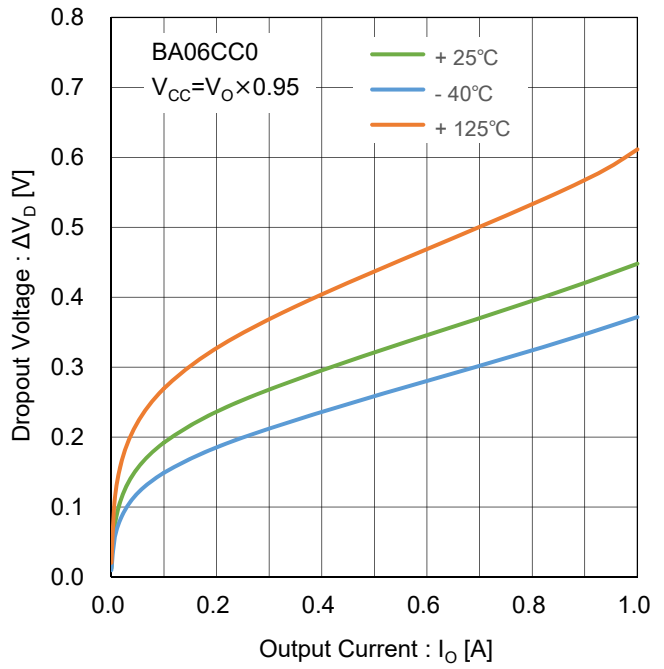


Figure 47. 最小入出力電圧差 vs 出力電流  
Test Circuit B

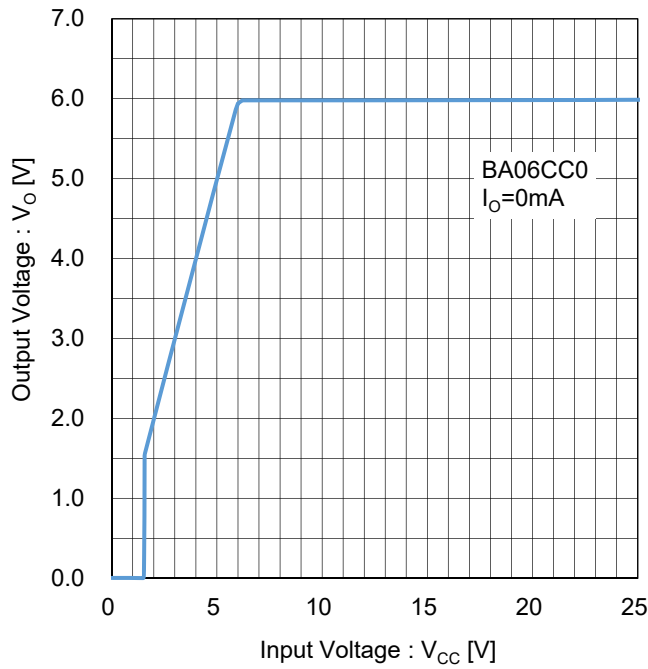


Figure 48. 出力電圧 vs 入力電圧  
( $I_o=0mA$ )  
Test Circuit C

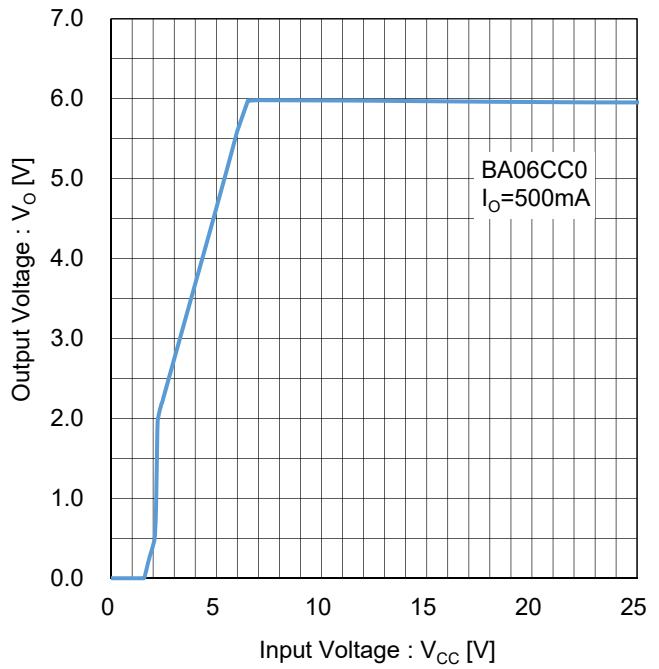


Figure 49. 出力電圧 vs 入力電圧  
( $I_o=500mA$ )  
Test Circuit C

BA06CC0 ( $V_O=6.0V$ )

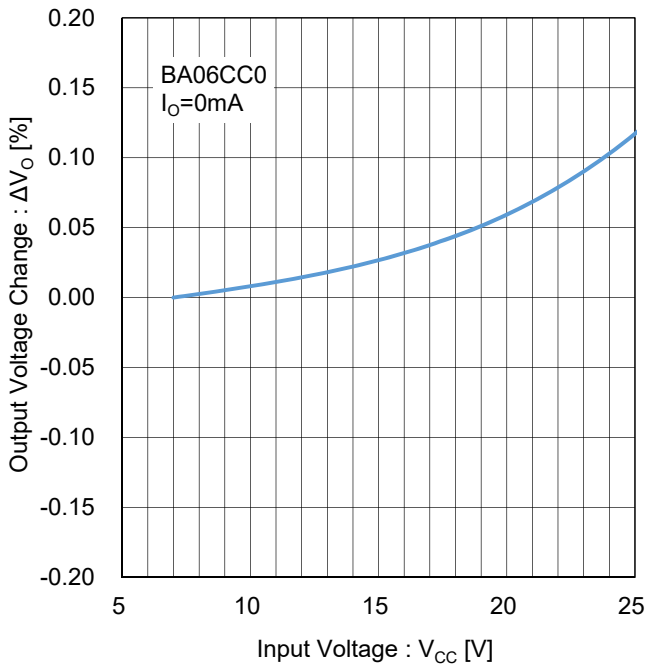


Figure 50. ラインレギュレーション  
( $I_o=0mA$ )  
Test Circuit D

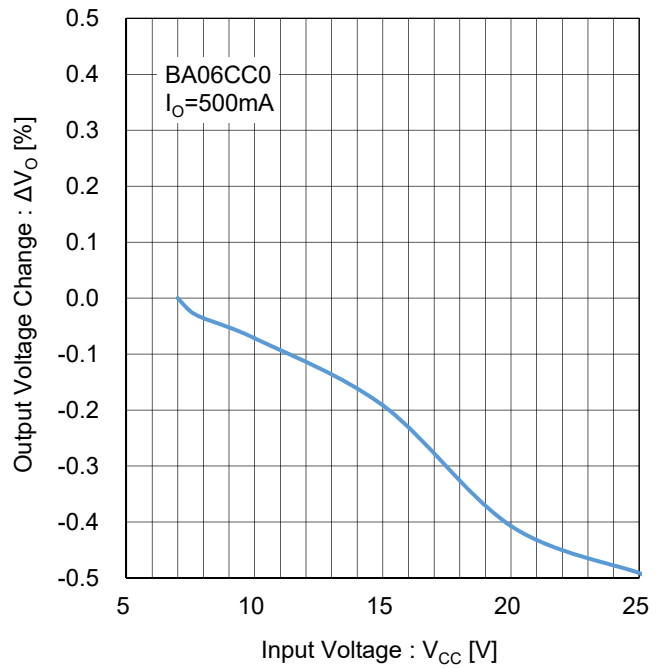


Figure 51. ラインレギュレーション  
( $I_o=500mA$ )  
Test Circuit D

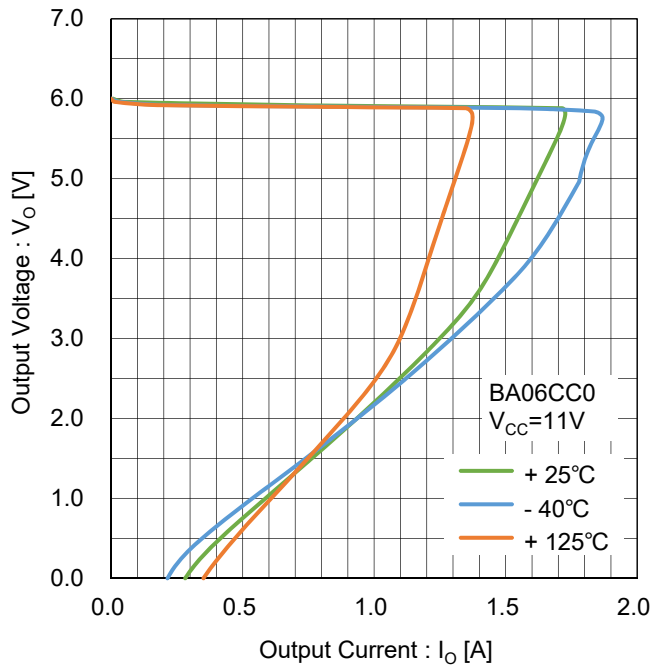


Figure 52. 過電流保護  
Test Circuit E

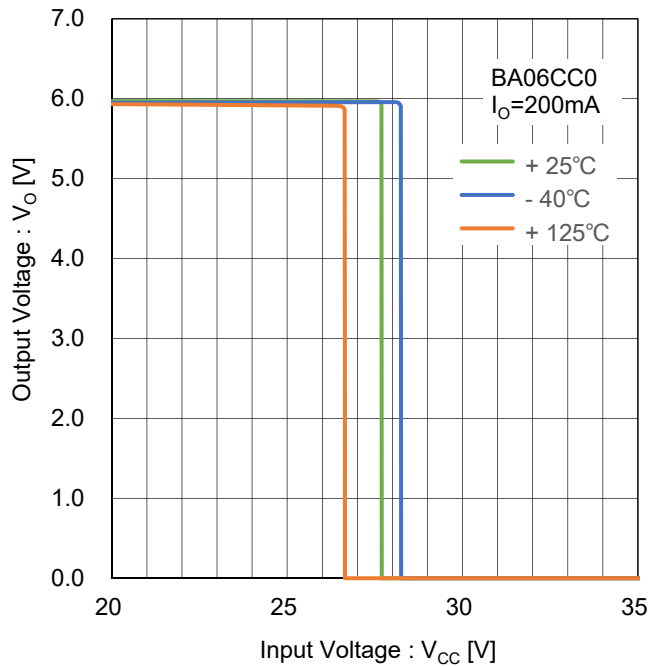


Figure 53. 過電圧動作  
Test Circuit F

BA06CC0 (V<sub>O</sub>=6.0V)

BAJ0CC0 のデータを参照

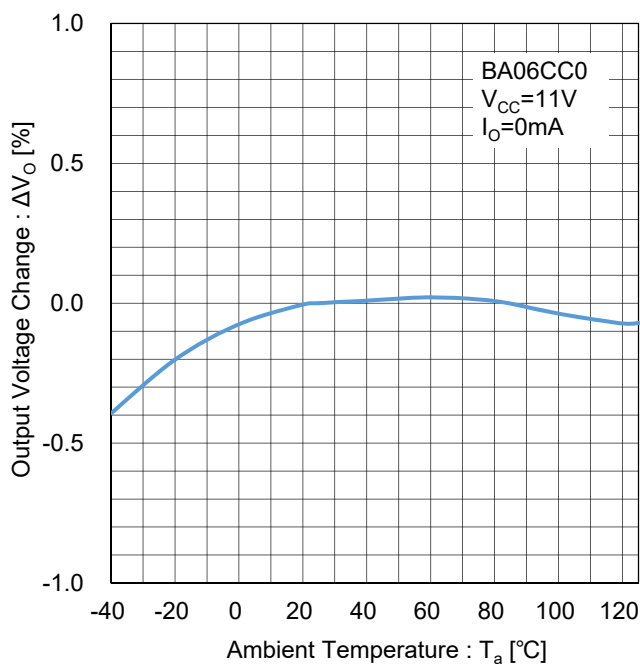


Figure 54. リップルリジェクション  
Test Circuit G

Figure 55. 出力電圧温度安定性  
Test Circuit H

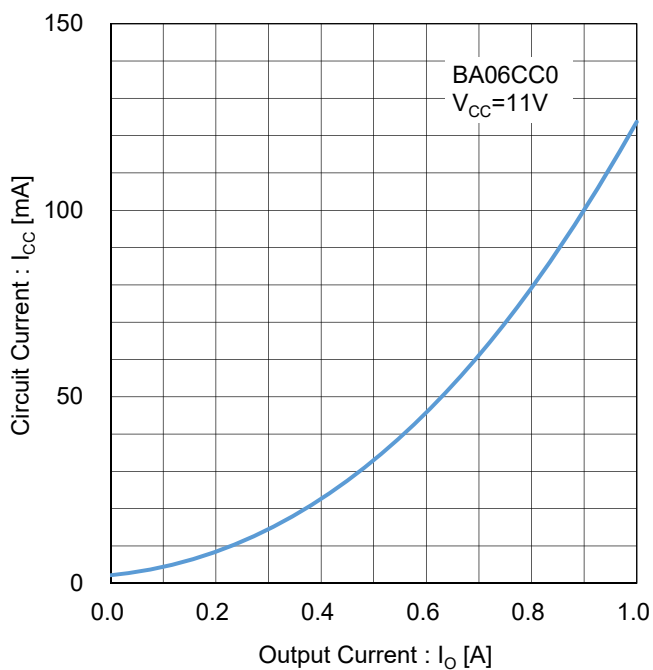


Figure 56. 回路電流 vs 出力電流  
Test Circuit I

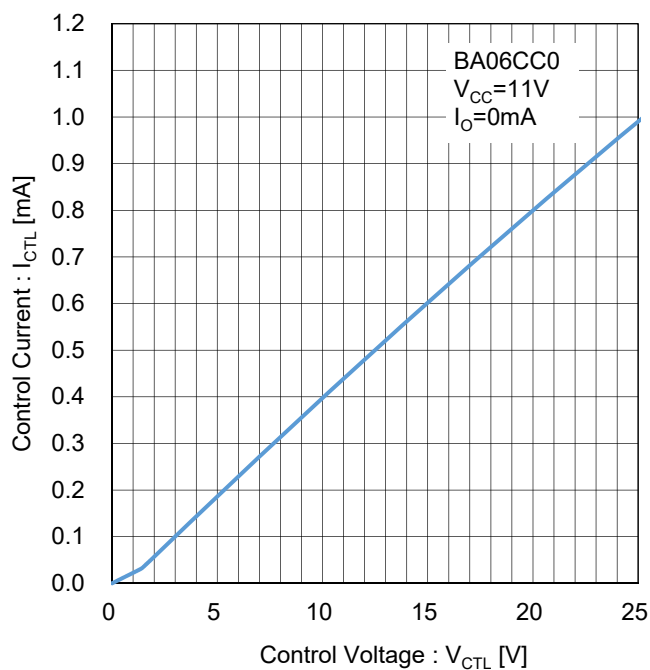


Figure 57. CTLピン流入電流  
Test Circuit J



BA06CC0 ( $V_o=6.0V$ )

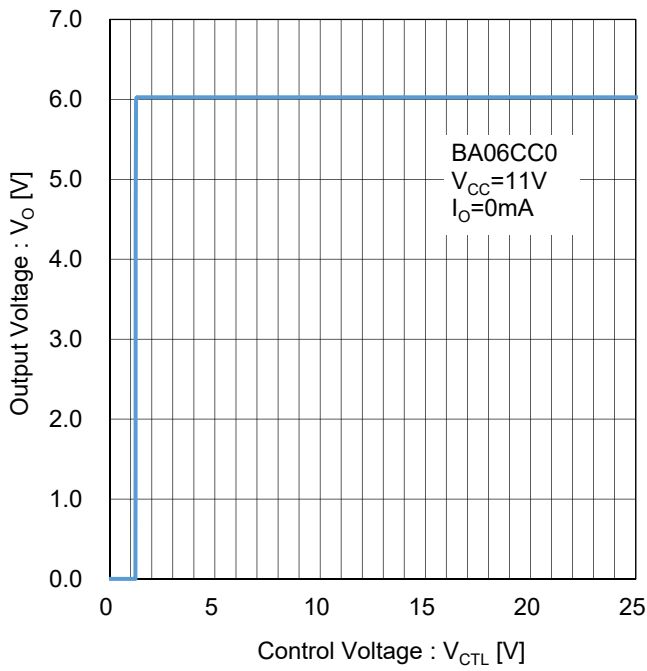


Figure 58. 出力電圧 vs CTL ピン電圧  
Test Circuit K

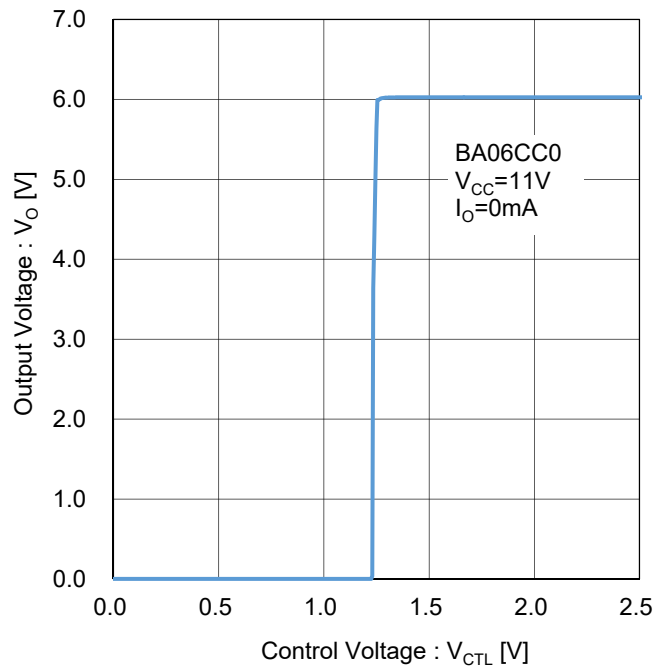


Figure 59. 出力電圧 vs CTL ピン電圧  
Test Circuit K

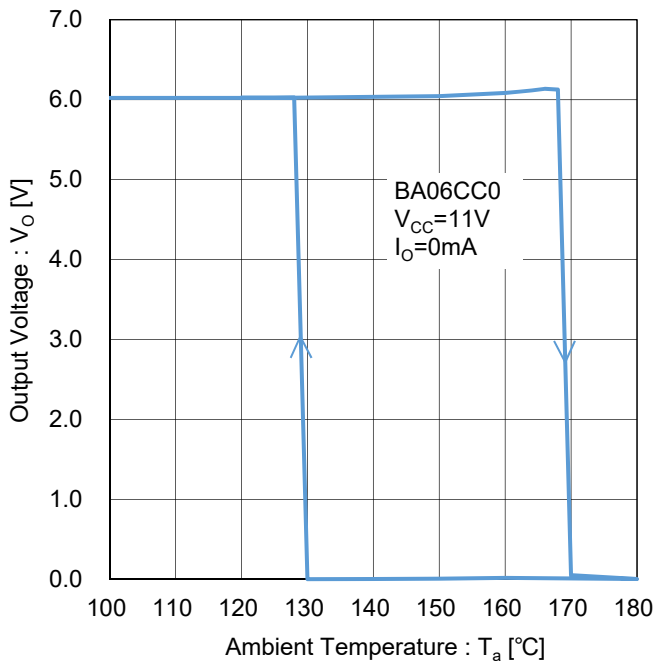


Figure 60. 過熱保護  
Test Circuit L

BA07CC0 ( $V_o=7.0V$ )

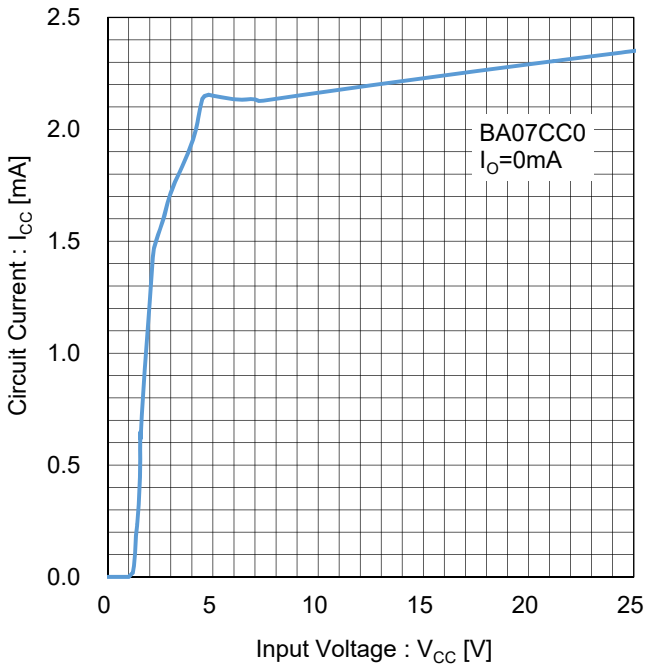


Figure 61. 回路電流  
Test Circuit A

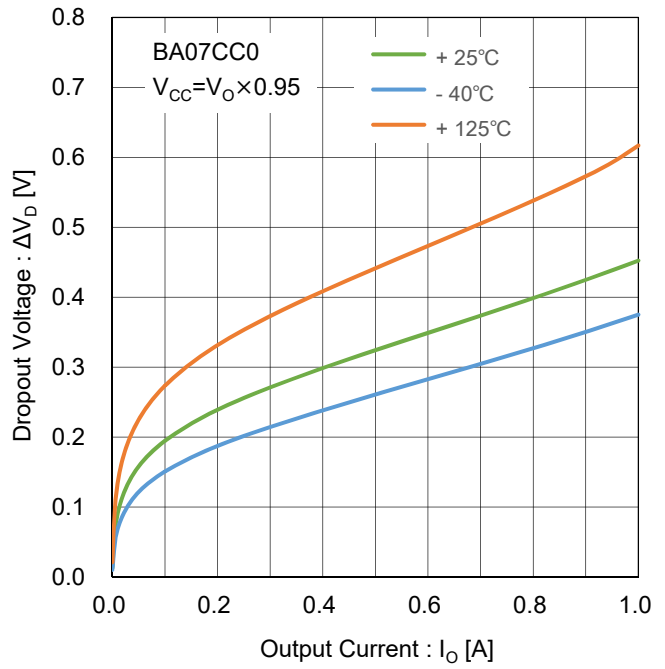


Figure 62. 最小入出力電圧差 vs 出力電流  
Test Circuit B

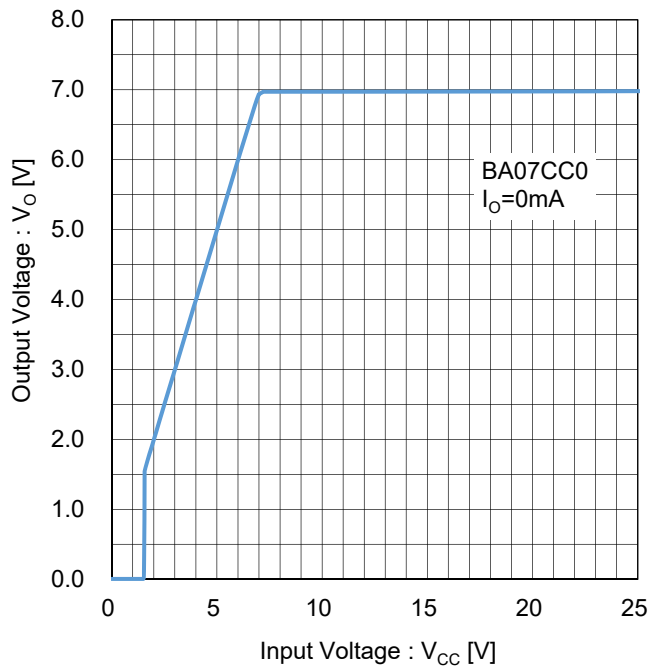


Figure 63. 出力電圧 vs 入力電圧  
( $I_o=0mA$ )  
Test Circuit C

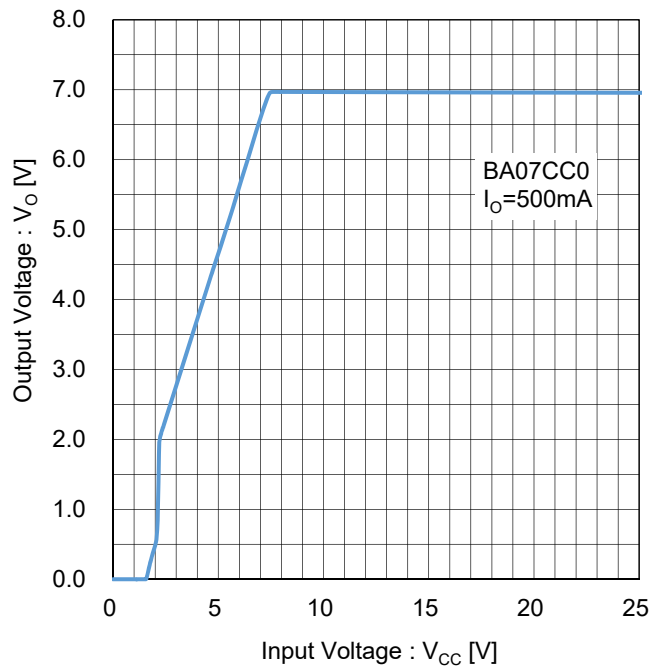


Figure 64. 出力電圧 vs 入力電圧  
( $I_o=500mA$ )  
Test Circuit C

BA07CC0 (V<sub>o</sub>=7.0V)

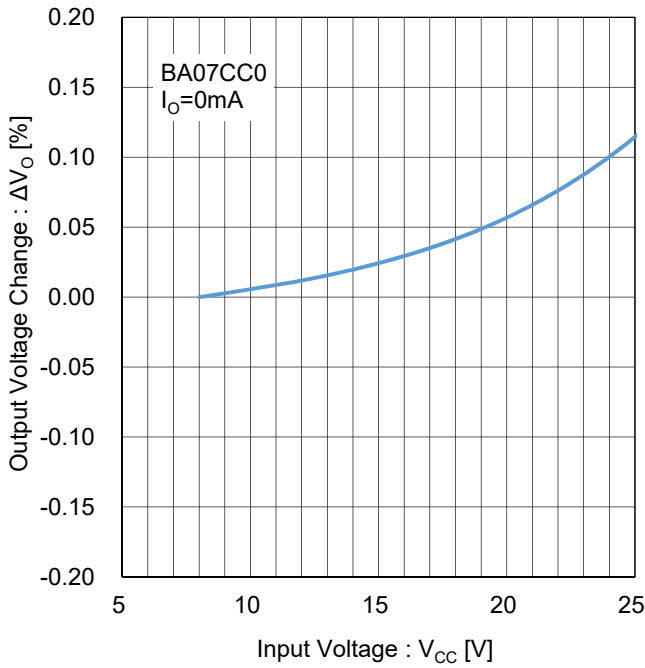


Figure 65. ラインレギュレーション  
(I<sub>o</sub>=0mA)  
Test Circuit D

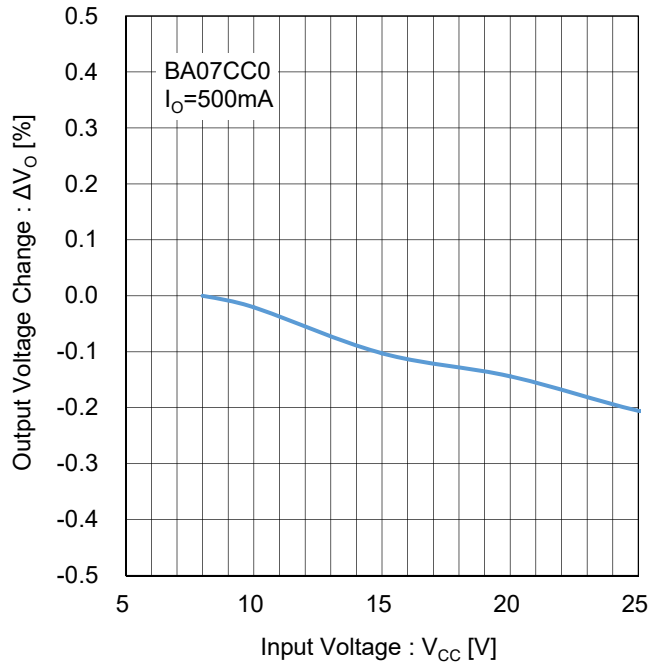


Figure 66. ラインレギュレーション  
(I<sub>o</sub>=500mA)  
Test Circuit D

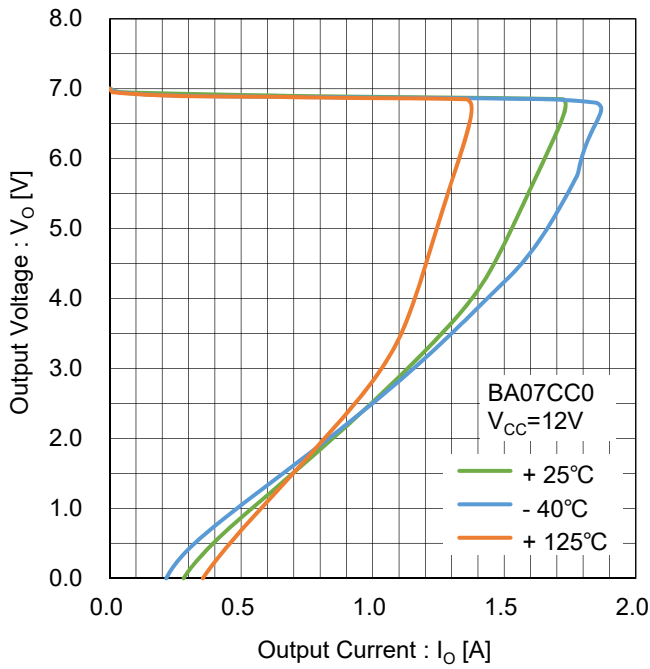


Figure 67. 過電流保護  
Test Circuit E

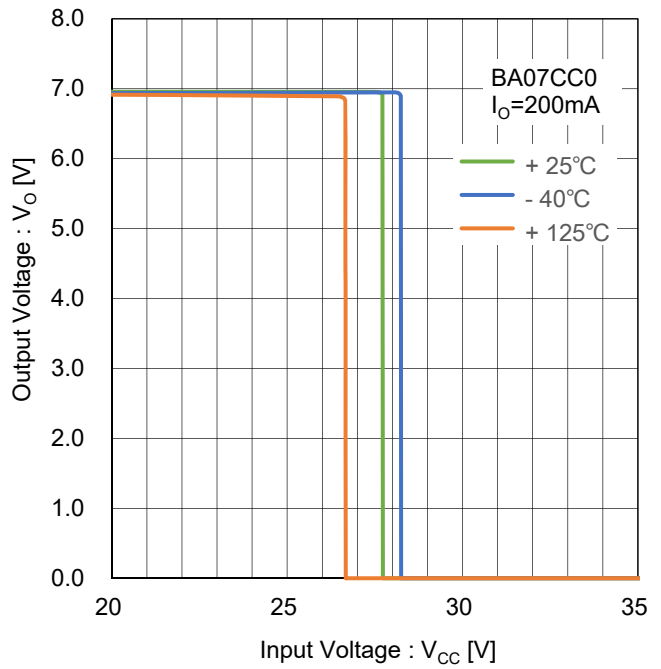


Figure 68. 過電圧動作  
Test Circuit F

BA07CC0 ( $V_o=7.0V$ )

BAJ0CC0 のデータを参照

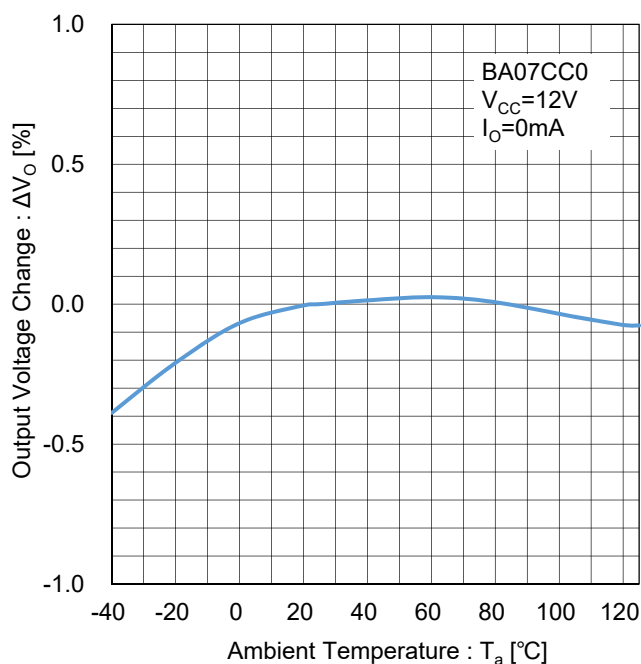


Figure 69. リップルリジェクション  
Test Circuit G

Figure 70. 出力電圧温度安定性  
Test Circuit H

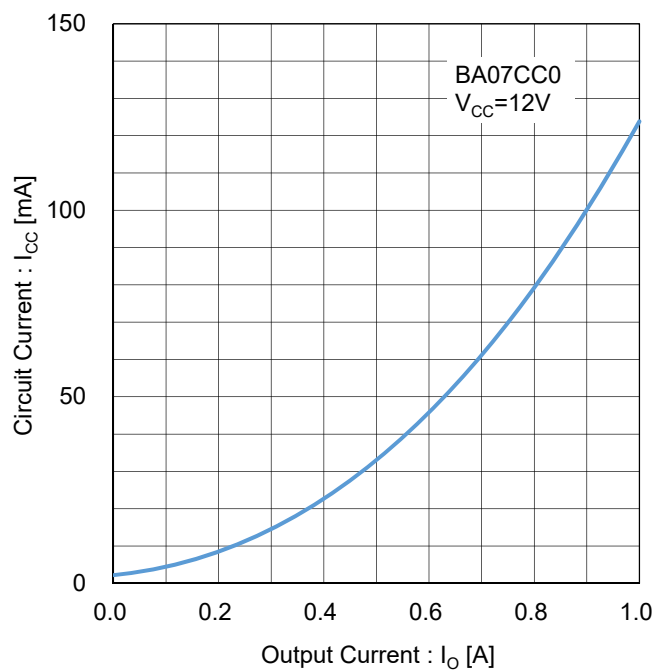


Figure 71. 回路電流 vs 出力電流  
Test Circuit I

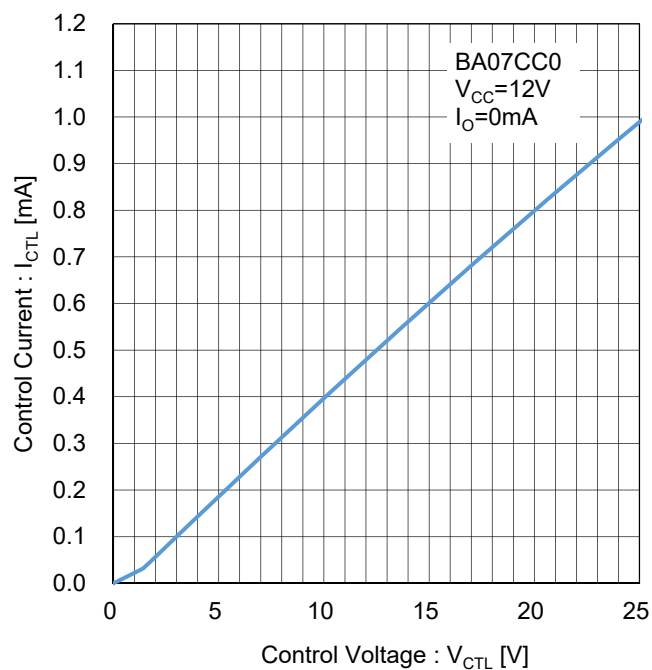


Figure 72. CTL ピン流入電流  
Test Circuit J

BA07CC0 ( $V_o=7.0V$ )

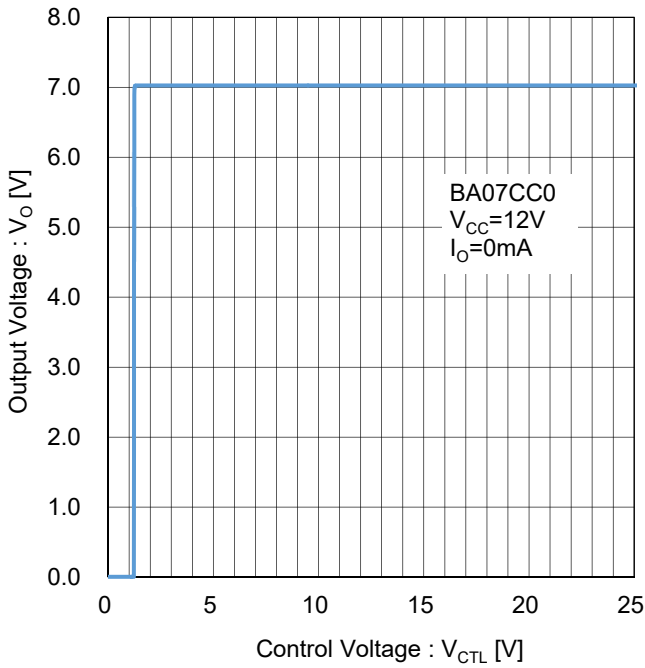


Figure 73. 出力電圧 vs CTL ピン電圧  
Test Circuit K

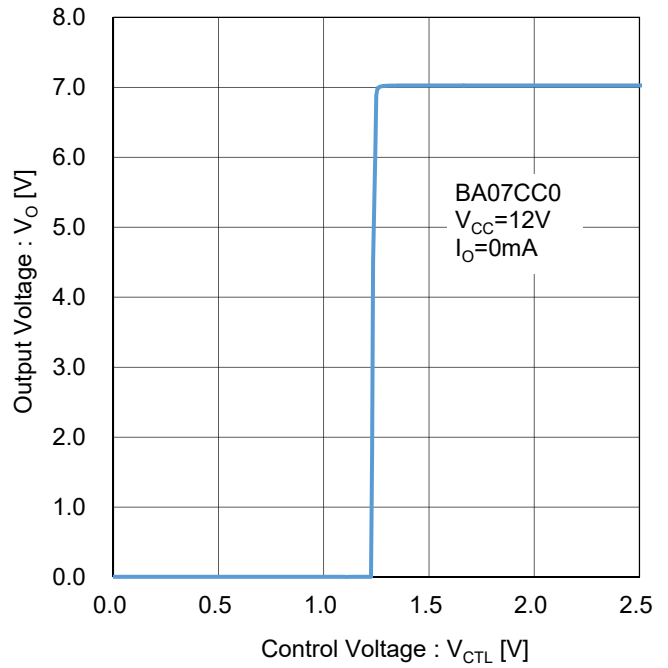


Figure 74. 出力電圧 vs CTL ピン電圧  
Test Circuit K

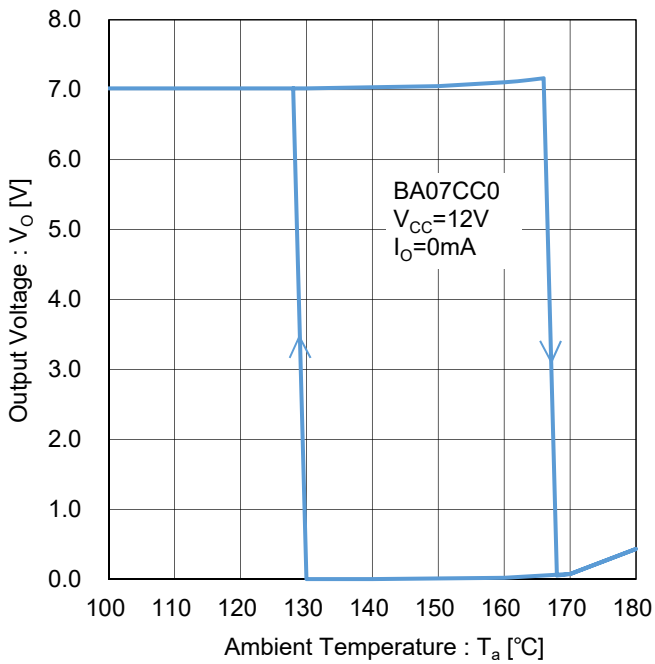


Figure 75. 過熱保護  
Test Circuit L

BA08CC0 ( $V_o=8.0V$ )

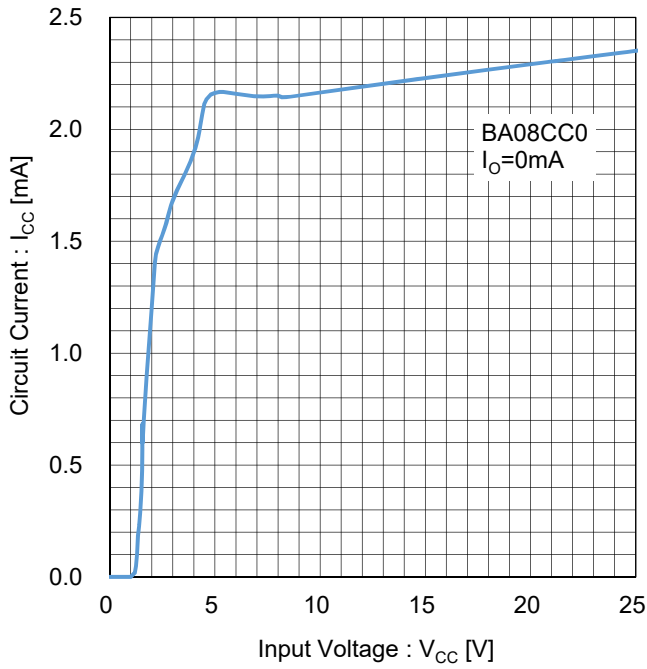


Figure 76. 回路電流  
Test Circuit A

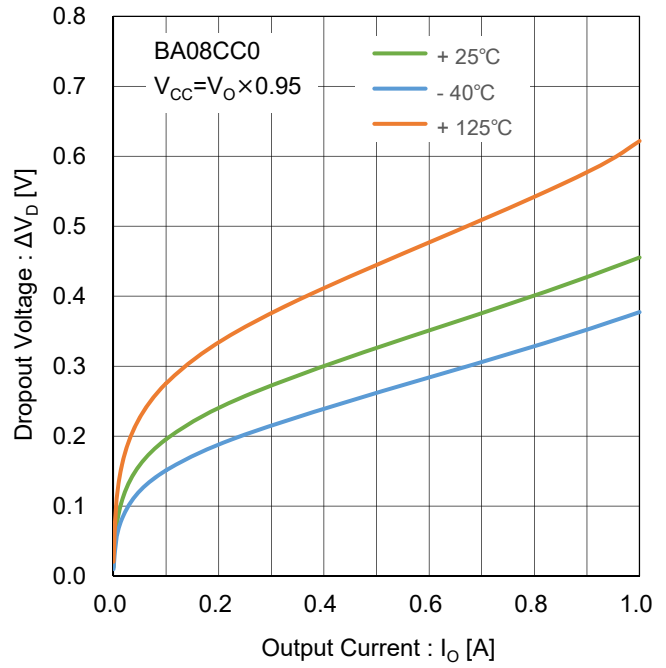


Figure 77. 最小入出力電圧差 vs 出力電流  
Test Circuit B

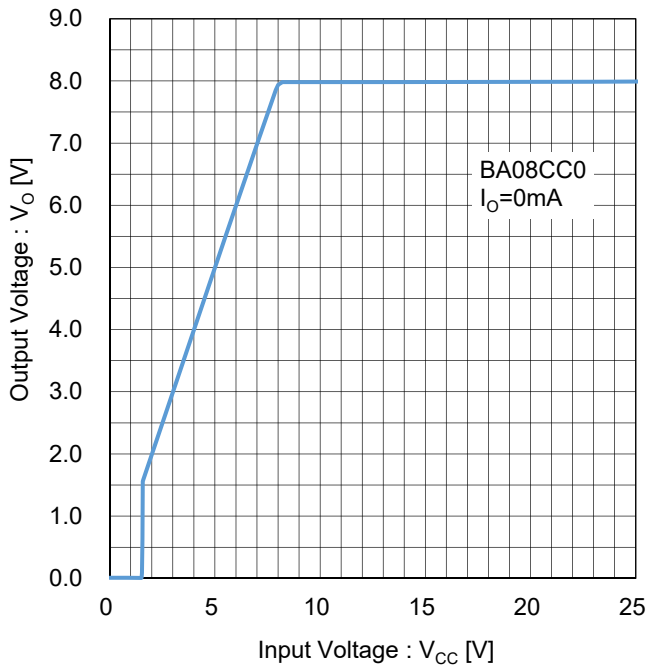


Figure 78. 出力電圧 vs 入力電圧  
( $I_o=0mA$ )  
Test Circuit C

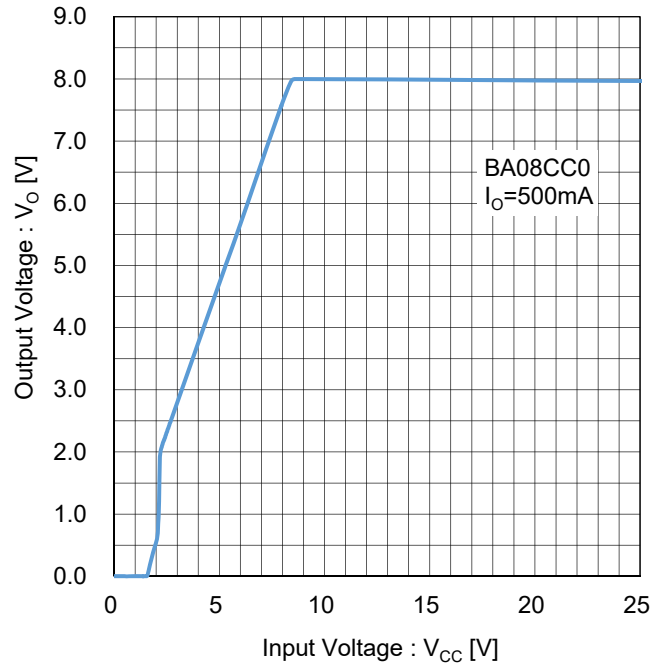


Figure 79. 出力電圧 vs 入力電圧  
( $I_o=500mA$ )  
Test Circuit C

BA08CC0 ( $V_O=8.0V$ )

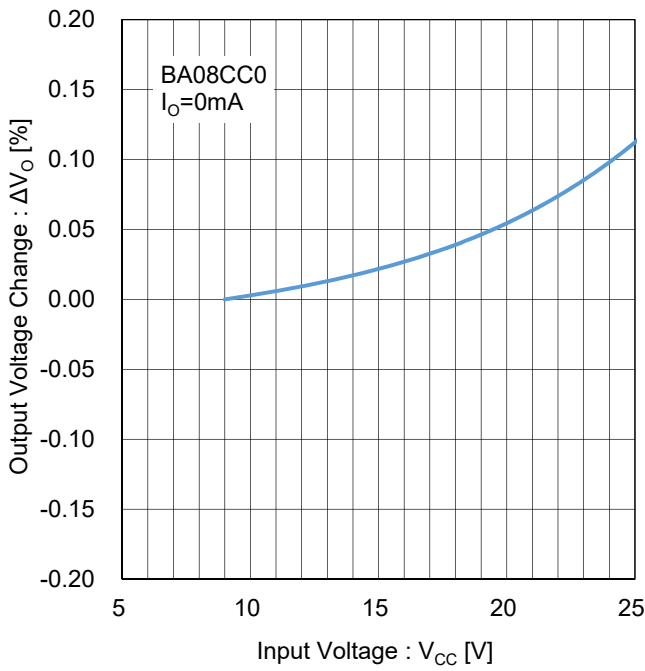


Figure 80. ラインレギュレーション  
( $I_O=0mA$ )  
Test Circuit D

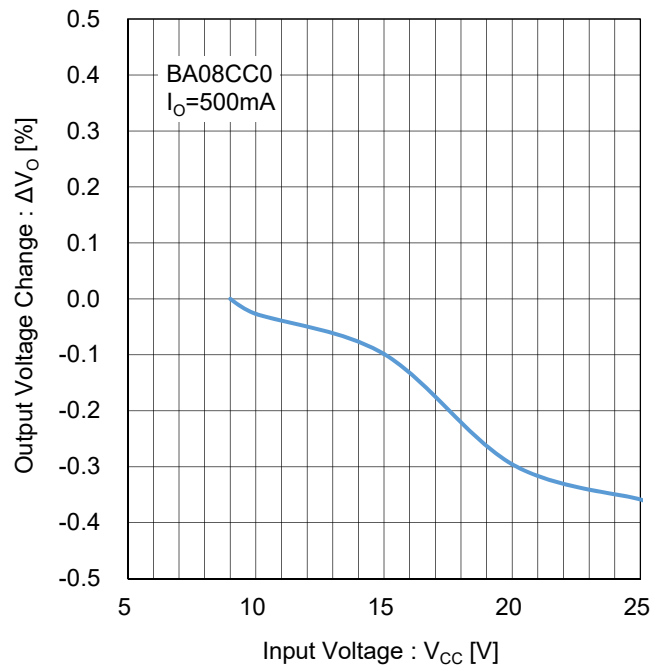


Figure 81. ラインレギュレーション  
( $I_O=500mA$ )  
Test Circuit D

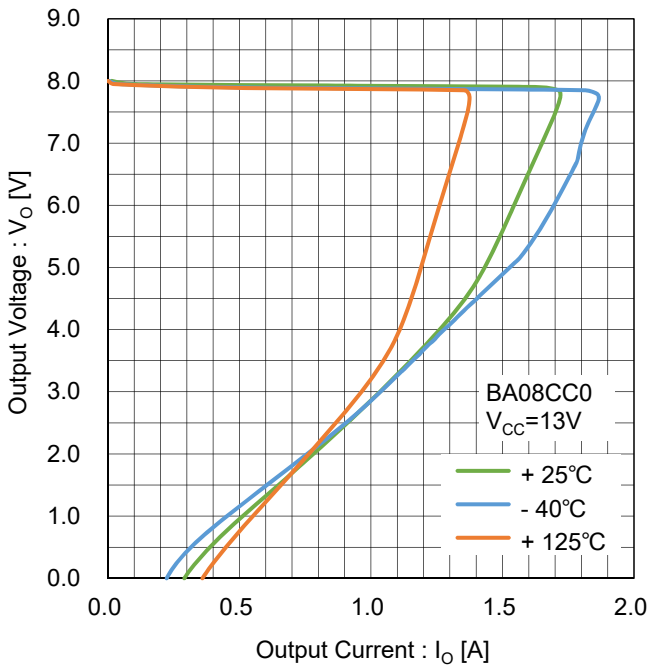


Figure 82. 過電流保護  
Test Circuit E

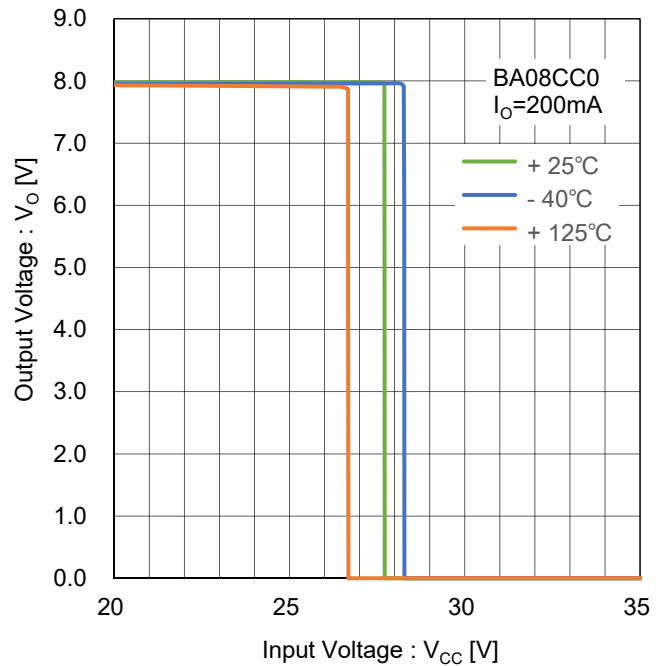


Figure 83. 過電圧動作  
Test Circuit F

BA08CC0 (V<sub>O</sub>=8.0V)

BAJ0CC0 のデータを参照

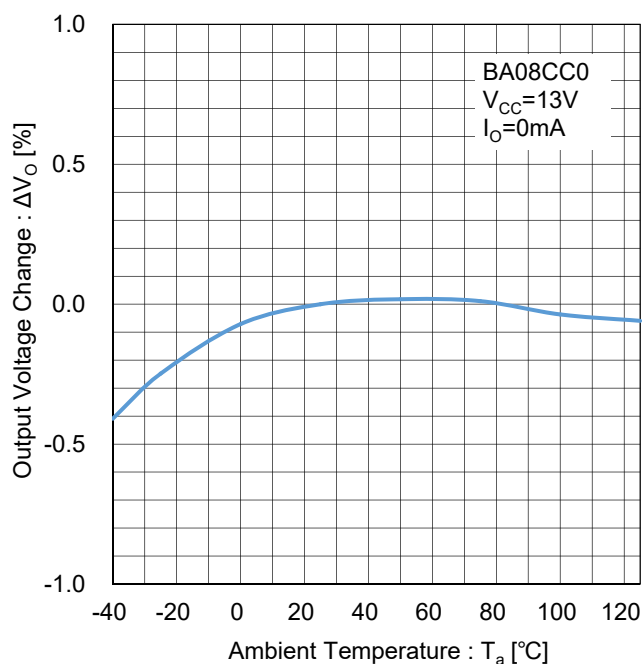


Figure 84. リップルリジェクション  
Test Circuit G

Figure 85. 出力電圧温度安定性  
Test Circuit H

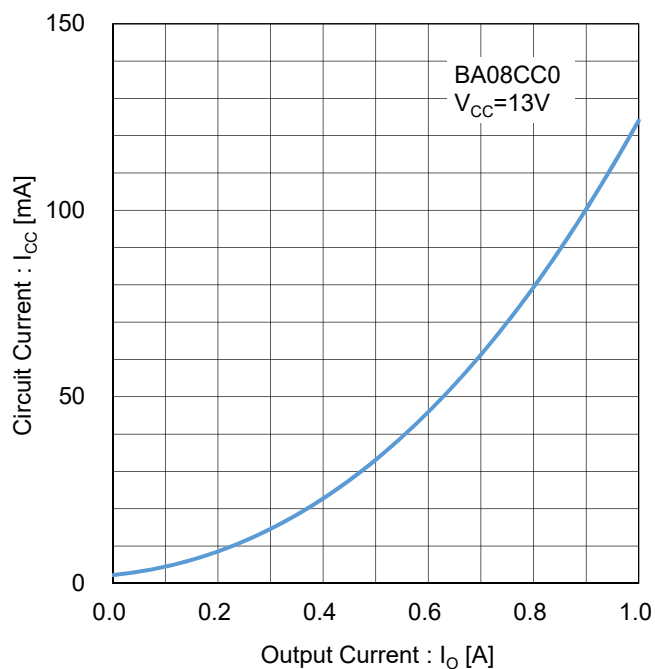


Figure 86. 回路電流 vs 出力電流  
Test Circuit I

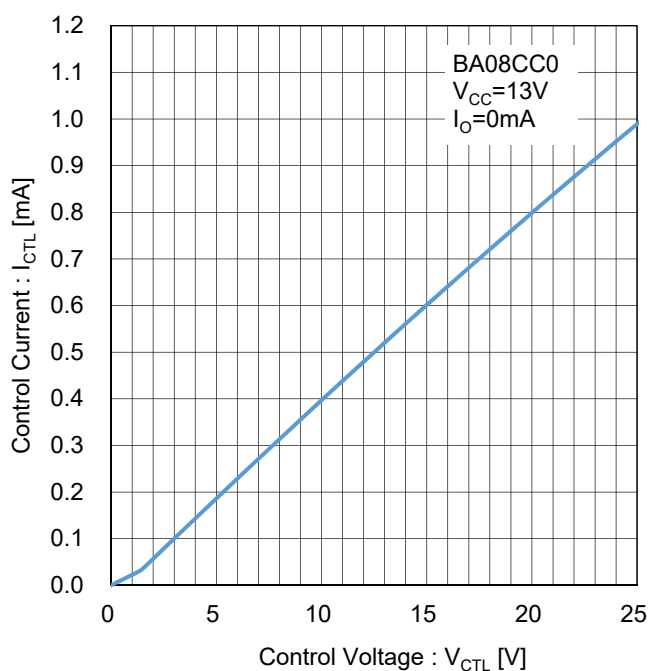


Figure 87. CTLピン流入電流  
Test Circuit J



BA08CC0 ( $V_O=8.0V$ )

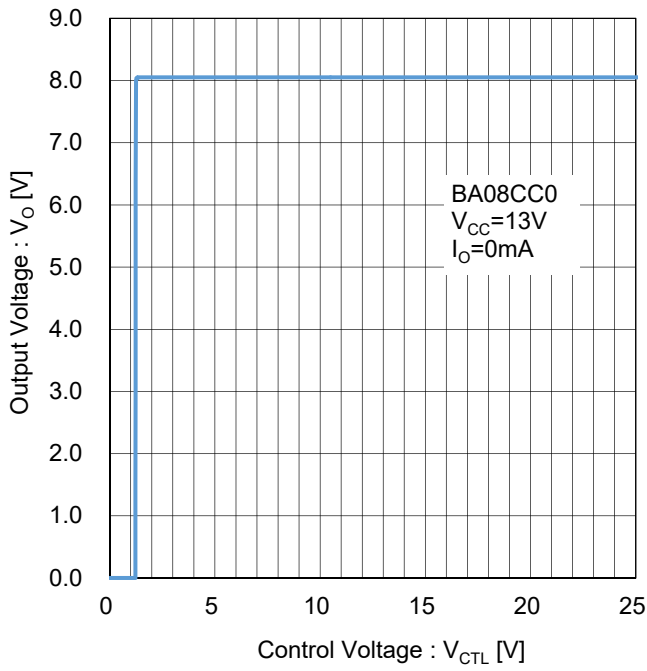


Figure 88. 出力電圧 vs CTL ピン電圧  
Test Circuit K

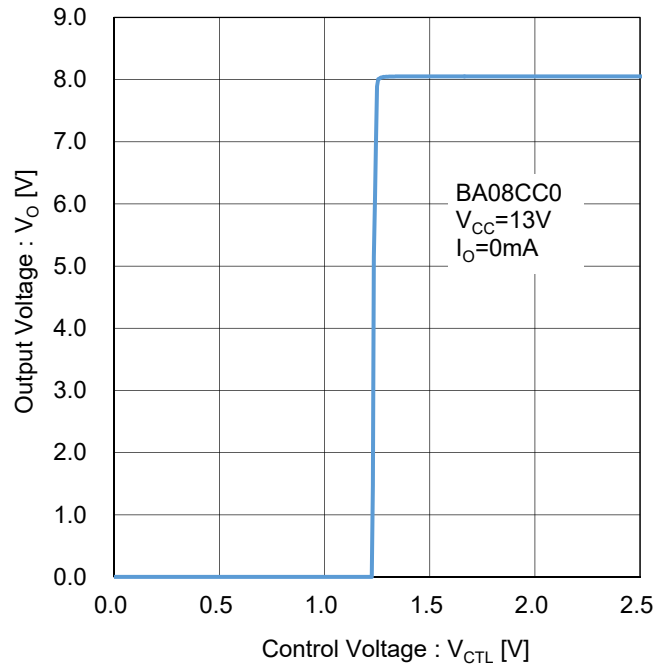


Figure 89. 出力電圧 vs CTL ピン電圧  
Test Circuit K

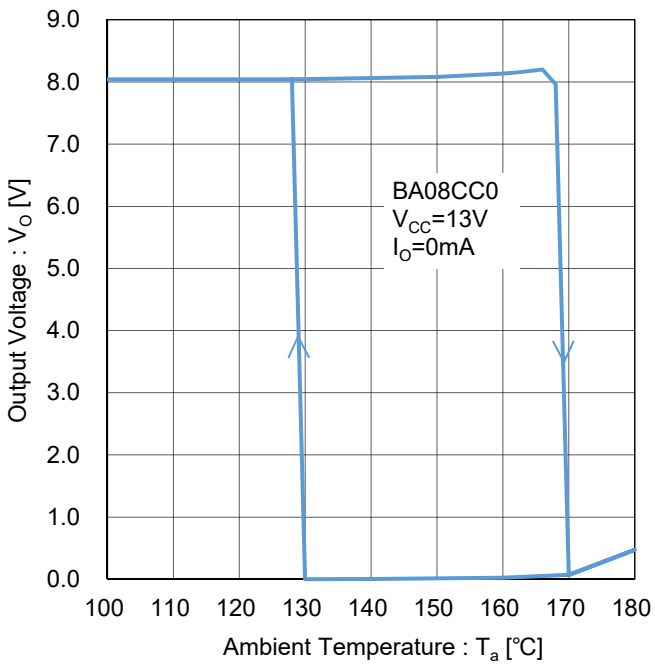


Figure 90. 過熱保護  
Test Circuit L

BA09CC0 ( $V_o=9.0V$ )

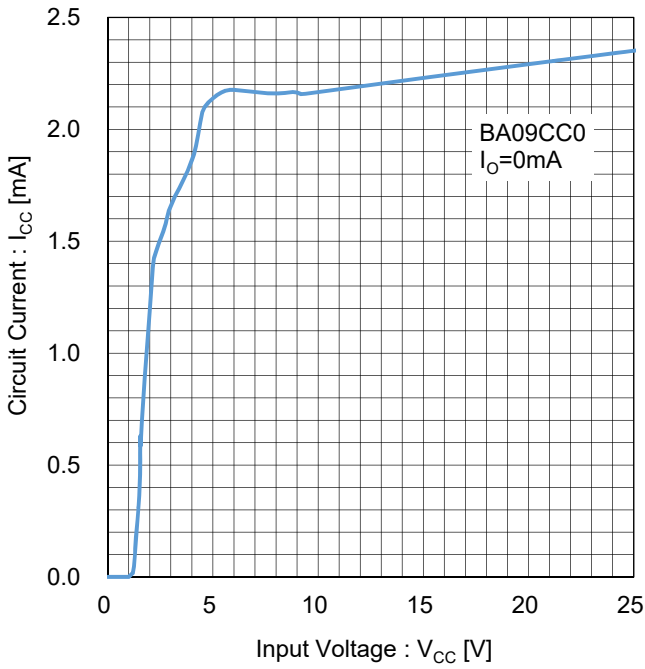


Figure 91. 回路電流  
Test Circuit A

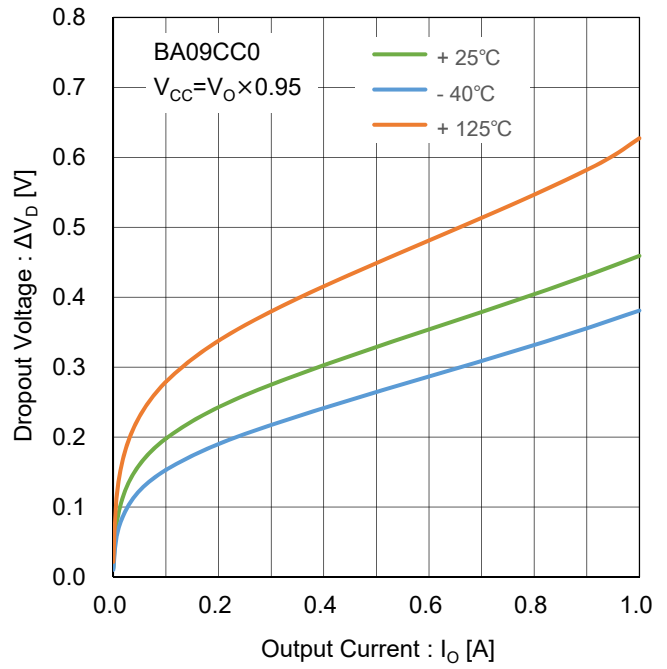


Figure 92. 最小入出力電圧差 vs 出力電流  
Test Circuit B

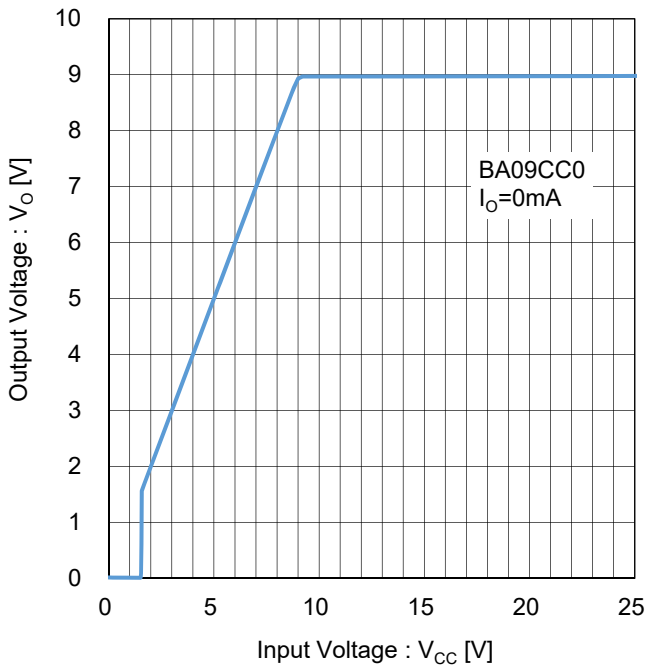


Figure 93. 出力電圧 vs 入力電圧  
( $I_o=0mA$ )  
Test Circuit C

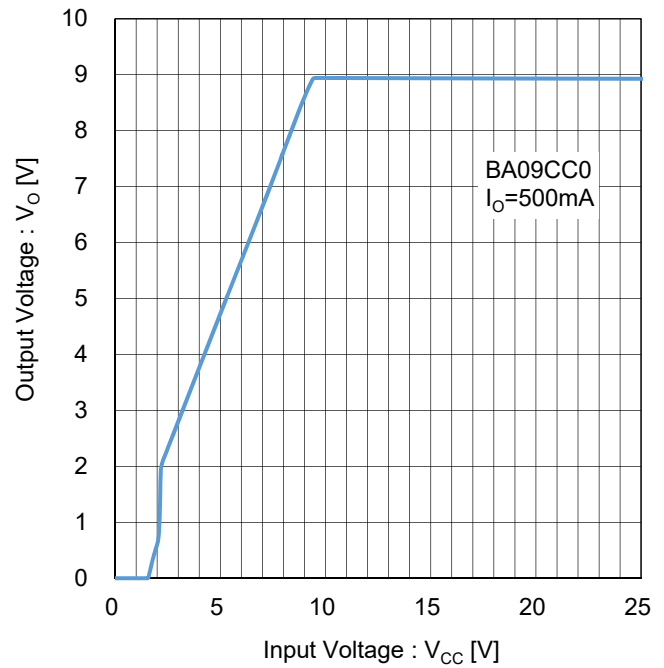


Figure 94. 出力電圧 vs 入力電圧  
( $I_o=500mA$ )  
Test Circuit C

BA09CC0 ( $V_O=9.0V$ )

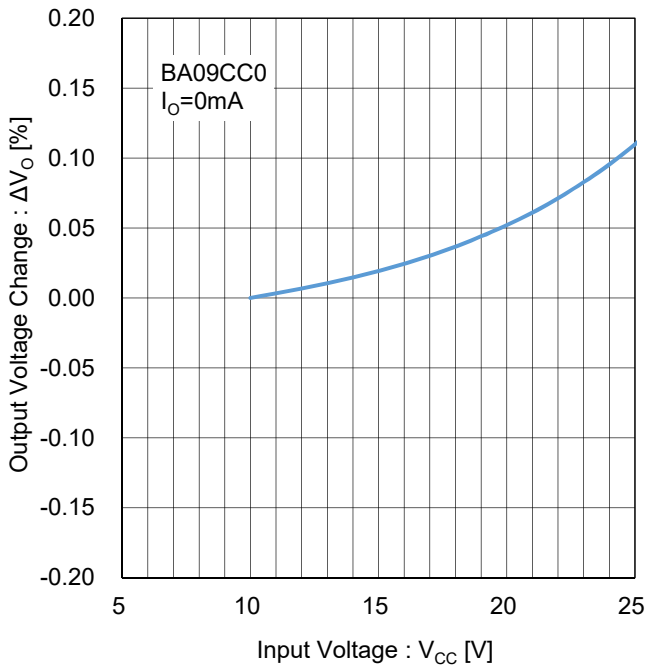


Figure 95. ラインレギュレーション  
( $I_o=0mA$ )  
Test Circuit D

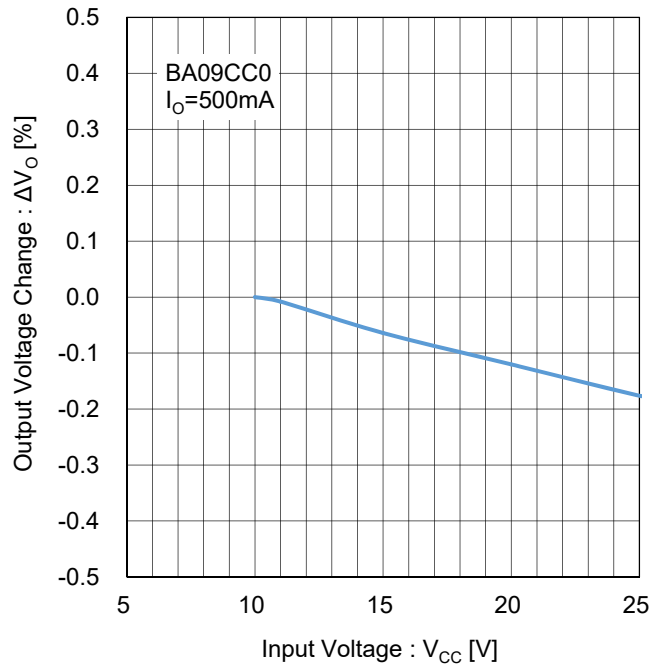


Figure 96. ラインレギュレーション  
( $I_o=500mA$ )  
Test Circuit D

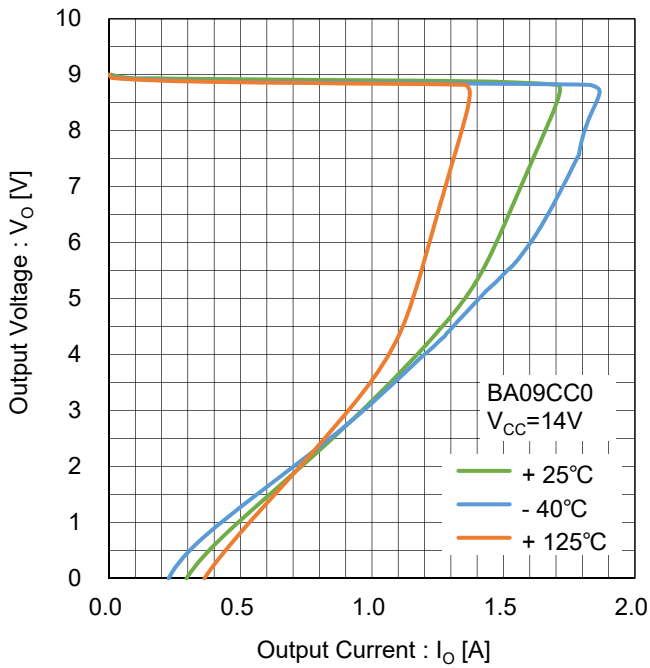


Figure 97. 過電流保護  
Test Circuit E

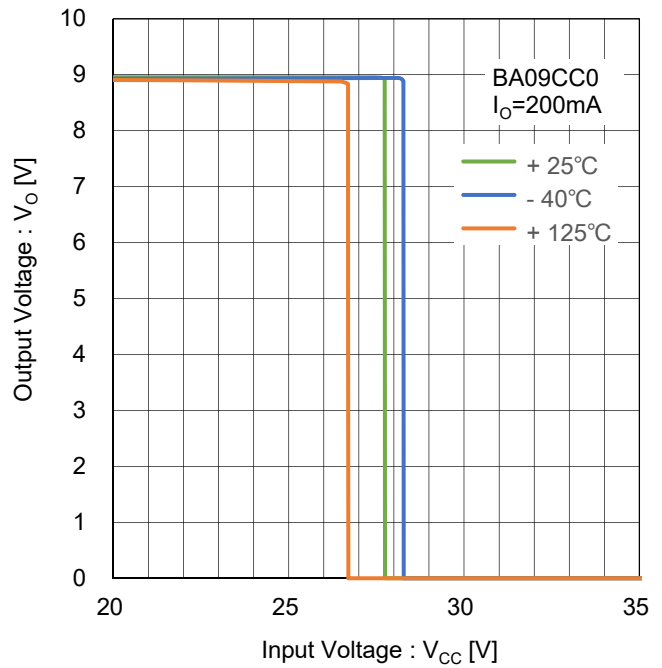


Figure 98. 過電圧動作  
Test Circuit F

BA09CC0 ( $V_O=9.0V$ )

BAJ0CC0 のデータを参照

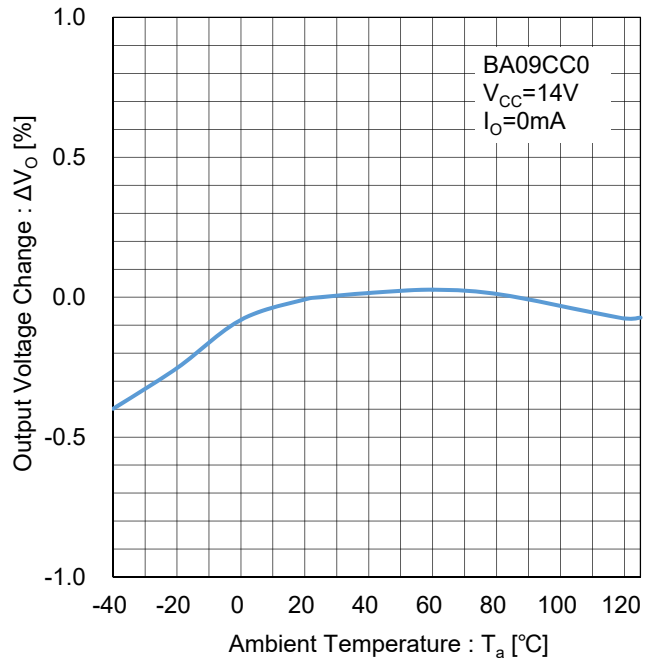


Figure 99. リップルリジェクション  
Test Circuit G

Figure 100. 出力電圧温度安定性  
Test Circuit H

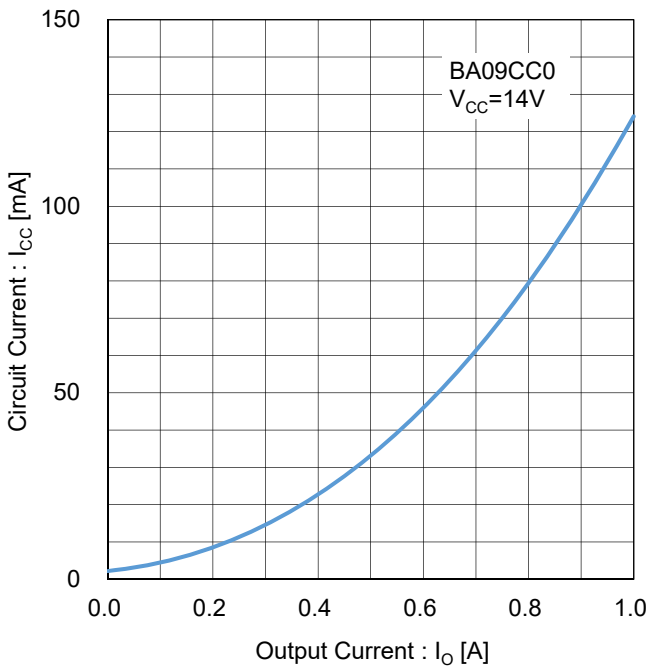


Figure 101. 回路電流 vs 出力電流  
Test Circuit I

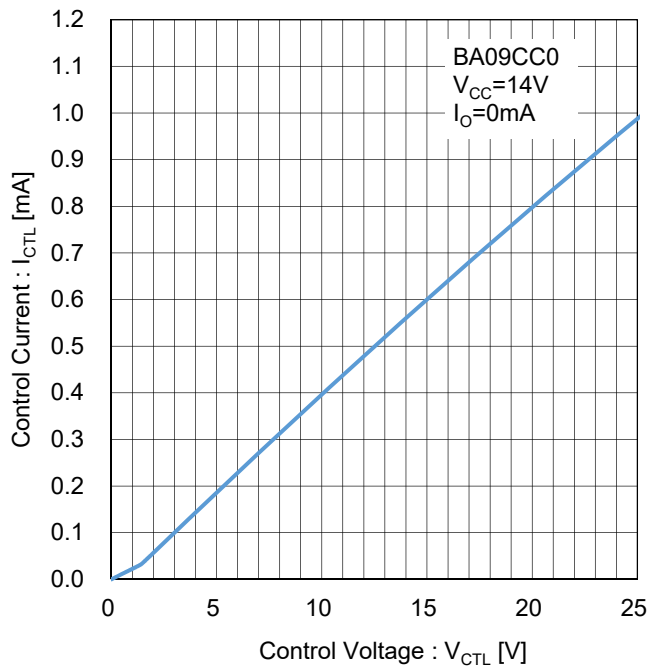


Figure 102. CTL ピン流入電流  
Test Circuit J

BA09CC0 ( $V_O=9.0V$ )

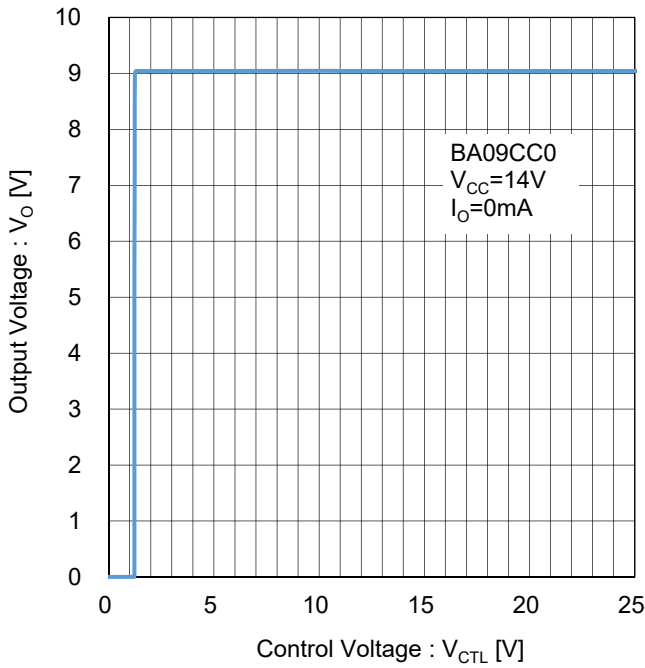


Figure 103. 出力電圧 vs CTL ピン電圧  
Test Circuit K

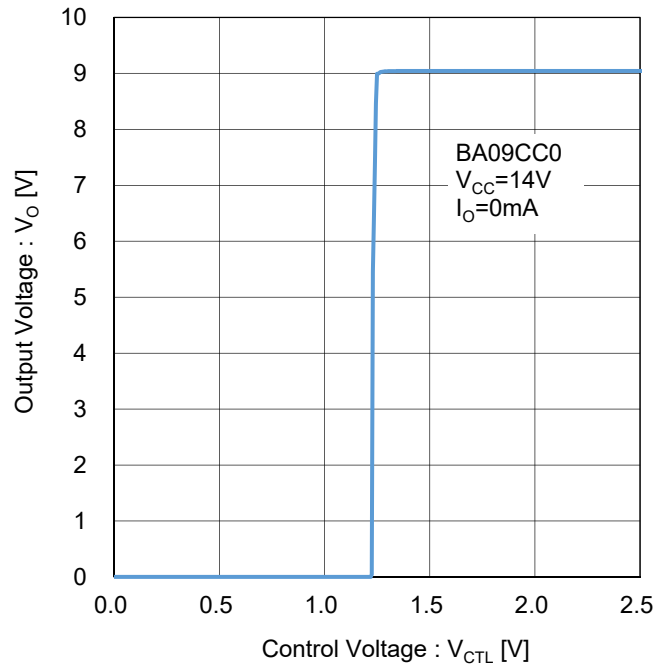


Figure 104. 出力電圧 vs CTL ピン電圧  
Test Circuit K

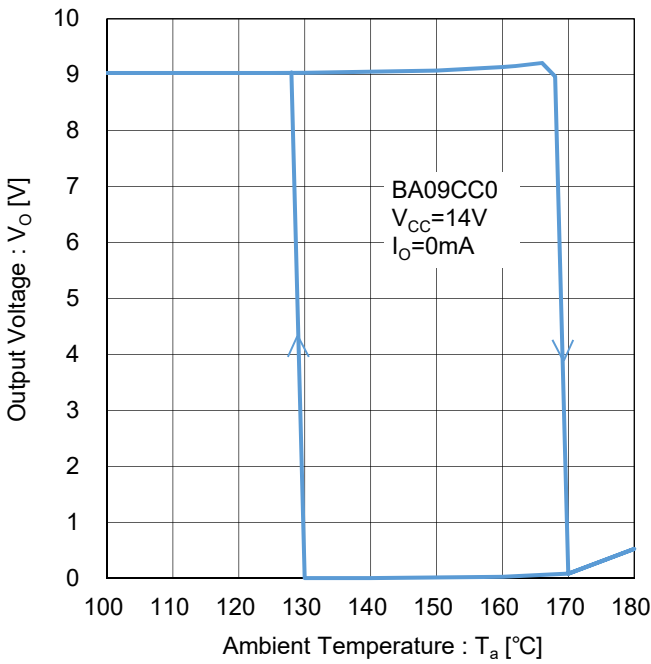


Figure 105. 過熱保護  
Test Circuit L

BAJ0CC0 ( $V_o=10V$ )

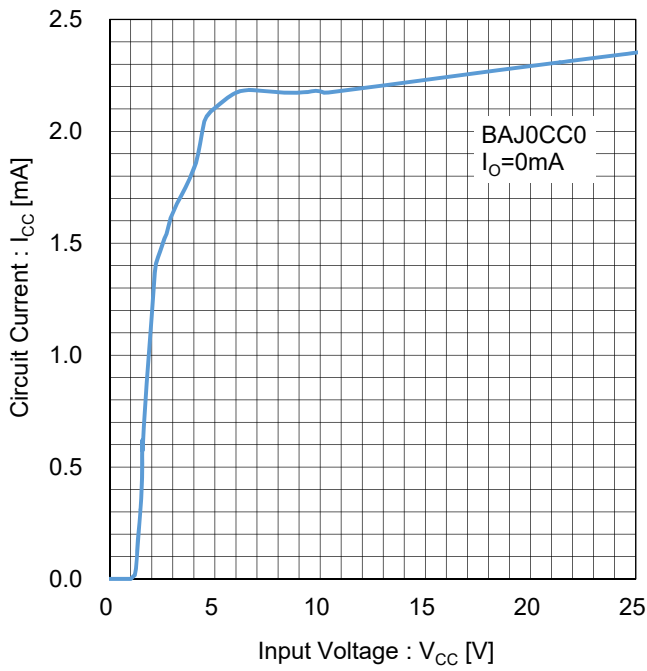


Figure 106. 回路電流  
Test Circuit A

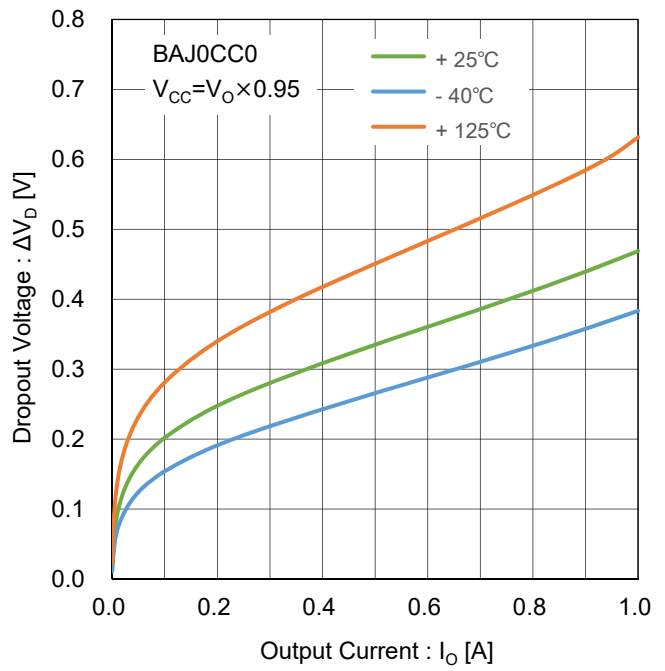


Figure 107. 最小入出力電圧差 vs 出力電流  
Test Circuit B

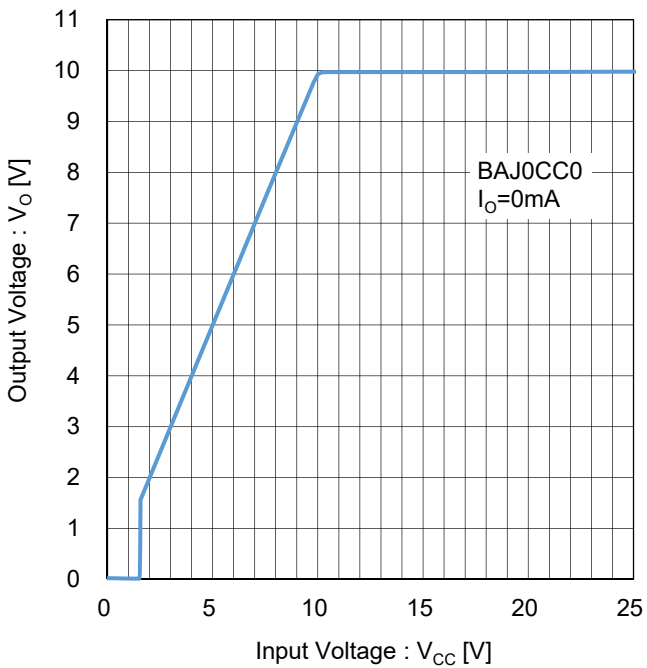


Figure 108. 出力電圧 vs 入力電圧  
( $I_o=0mA$ )  
Test Circuit C

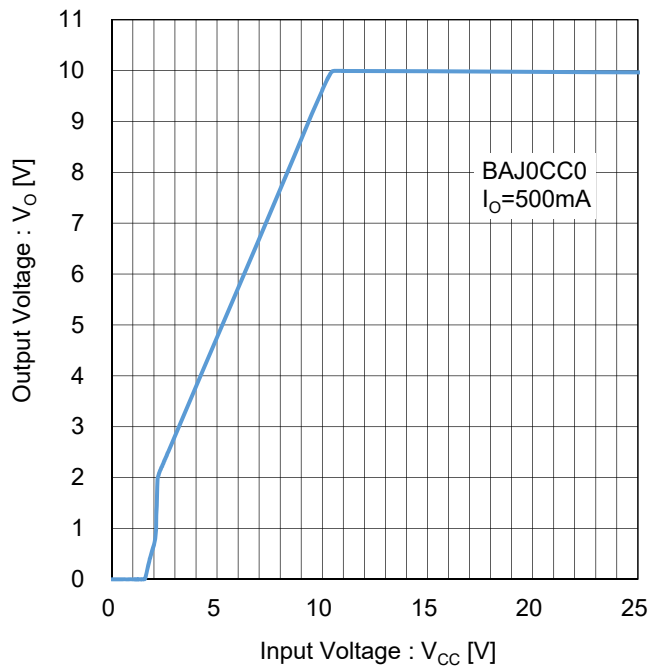


Figure 109. 出力電圧 vs 入力電圧  
( $I_o=500mA$ )  
Test Circuit C

BAJ0CC0 ( $V_O=10V$ )

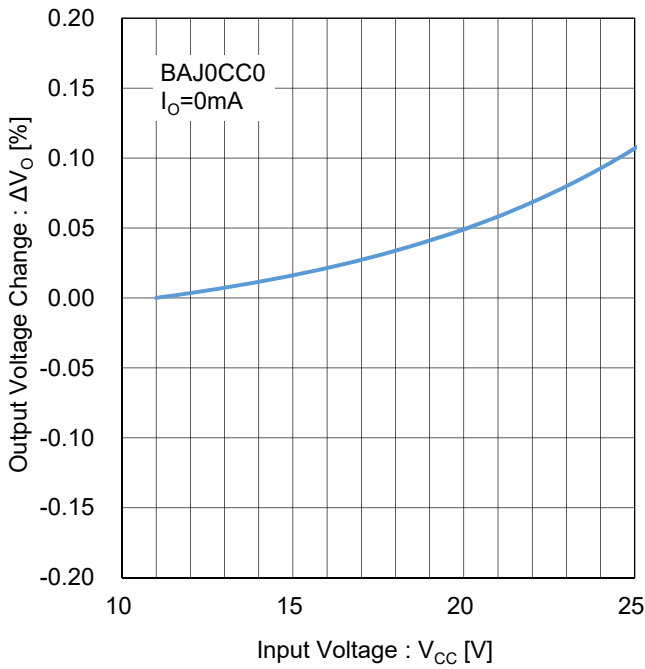


Figure 110. ラインレギュレーション  
( $I_O=0mA$ )  
Test Circuit D

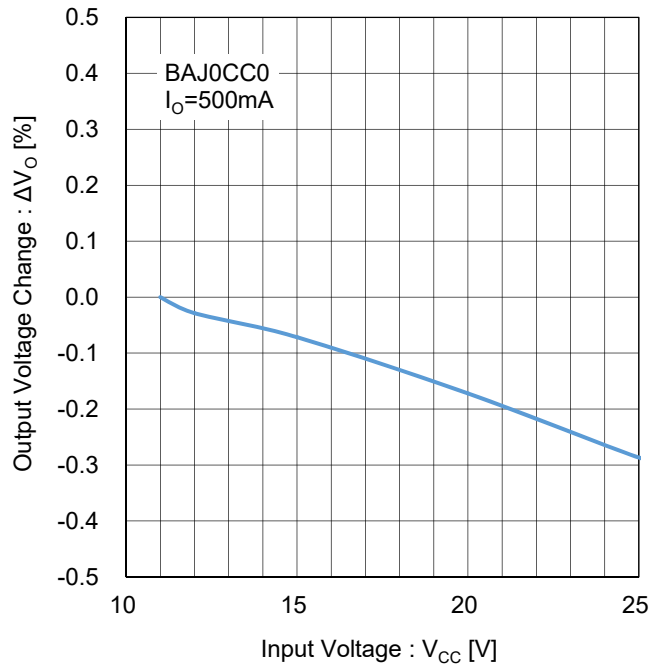


Figure 111. ラインレギュレーション  
( $I_O=500mA$ )  
Test Circuit D

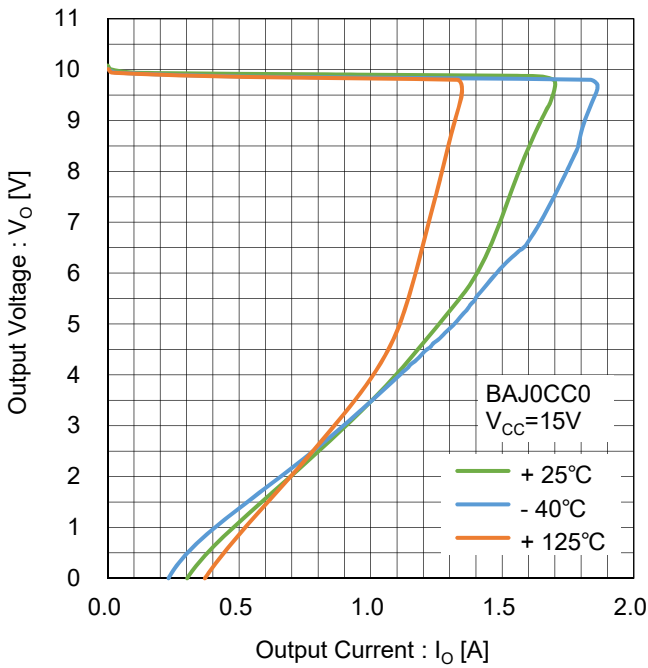


Figure 112. 過電流保護  
Test Circuit E

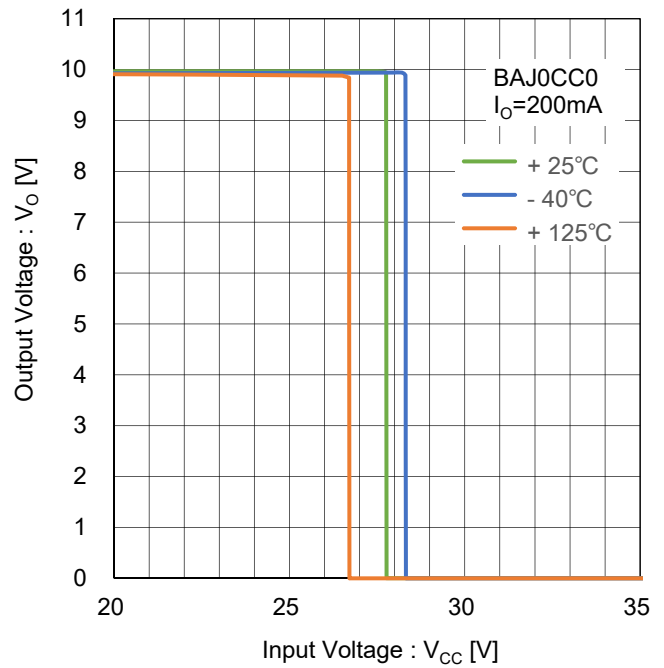


Figure 113. 過電圧動作  
Test Circuit F

BAJ0CC0 ( $V_O=10V$ )

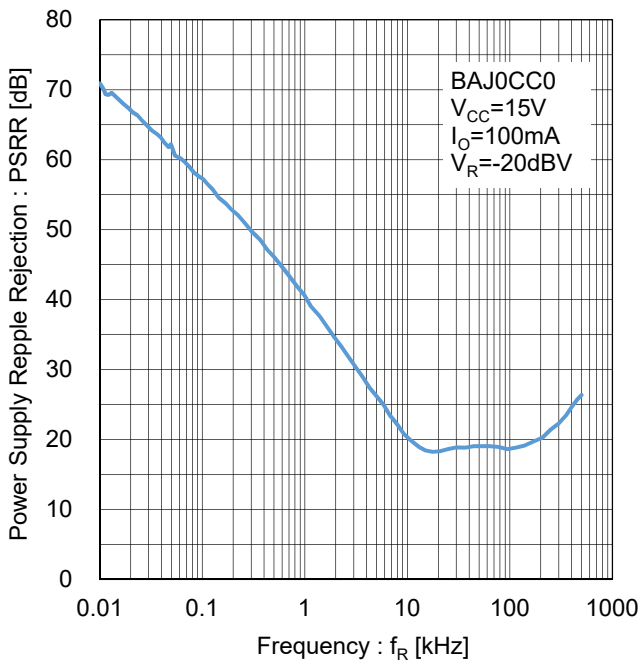


Figure 114. リップルリジェクション  
Test Circuit G

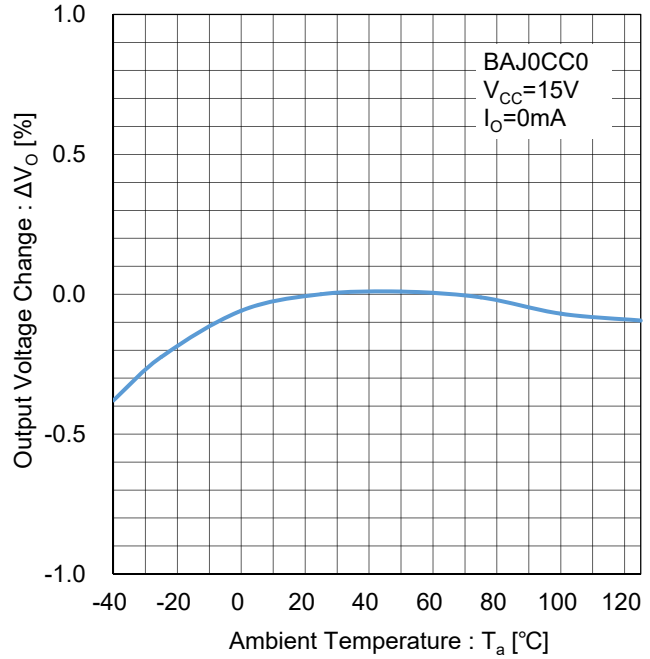


Figure 115. 出力電圧温度安定性  
Test Circuit H

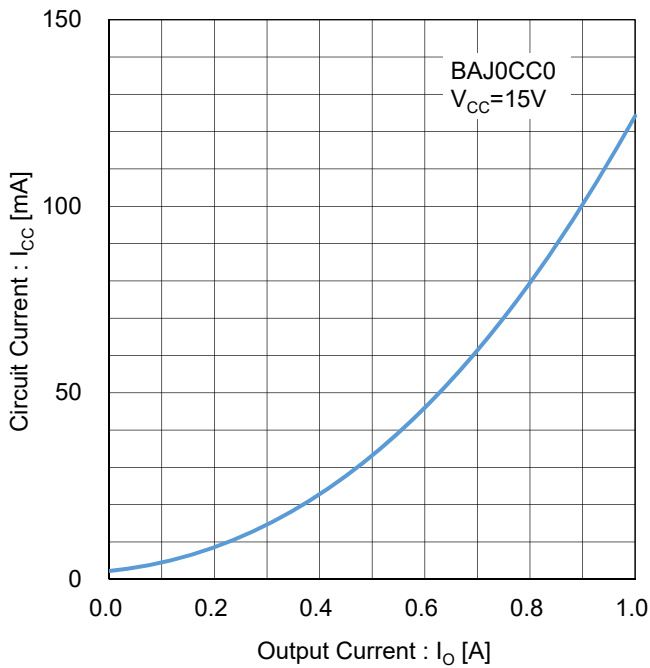


Figure 116. 回路電流 vs 出力電流  
Test Circuit I

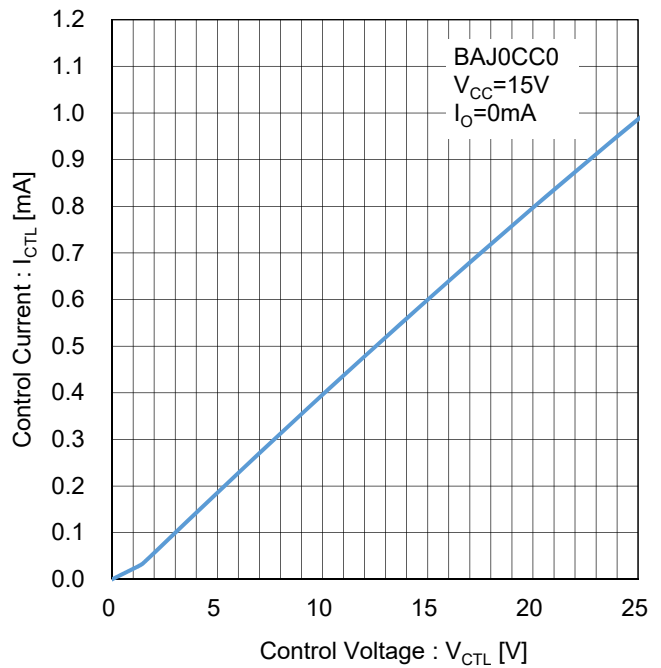


Figure 117. CTL ピン流入電流  
Test Circuit J



BAJ0CC0 ( $V_o=10V$ )

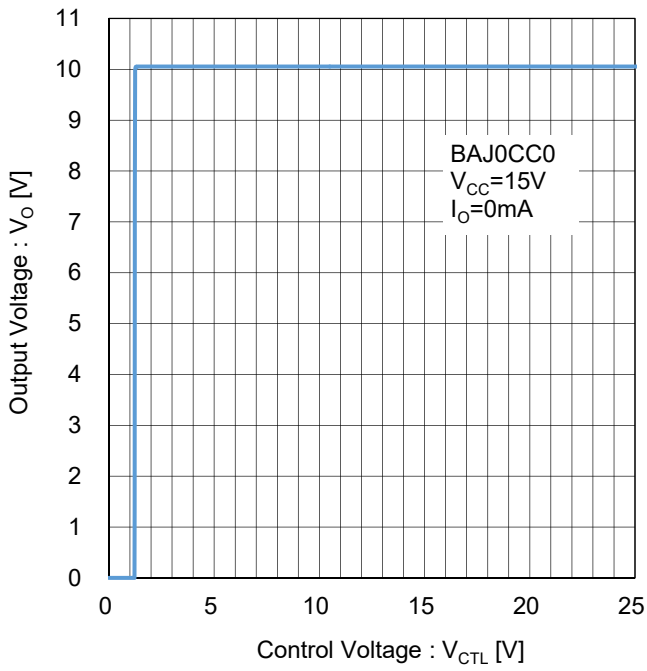


Figure 118. 出力電圧 vs CTL ピン電圧  
 Test Circuit K

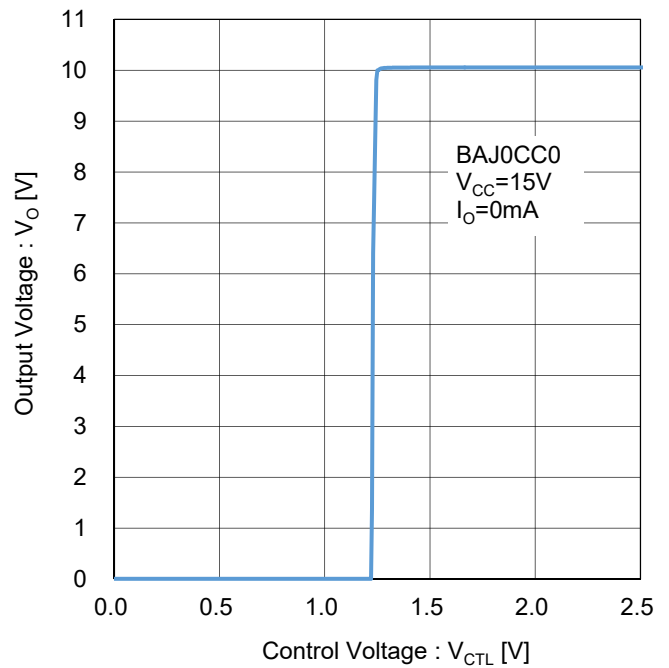


Figure 119. 出力電圧 vs CTL ピン電圧  
 Test Circuit K

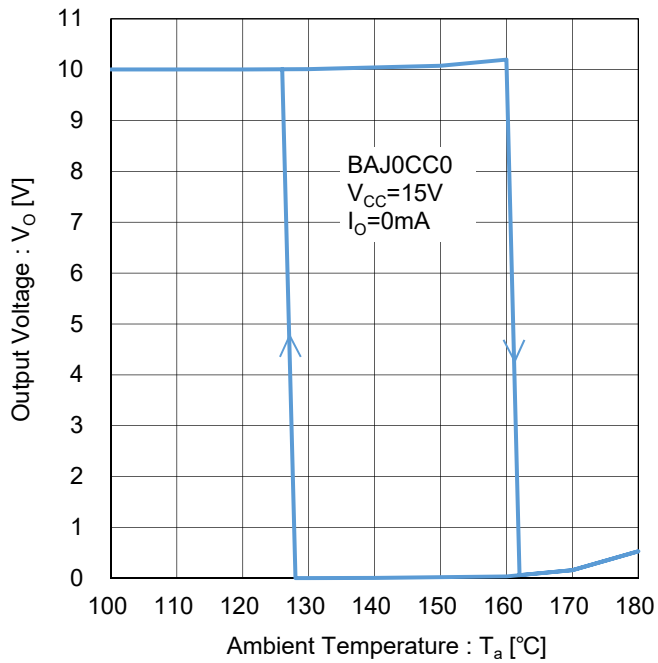


Figure 120. 過熱保護  
 Test Circuit L

BAJ2CC0 ( $V_o=12V$ )

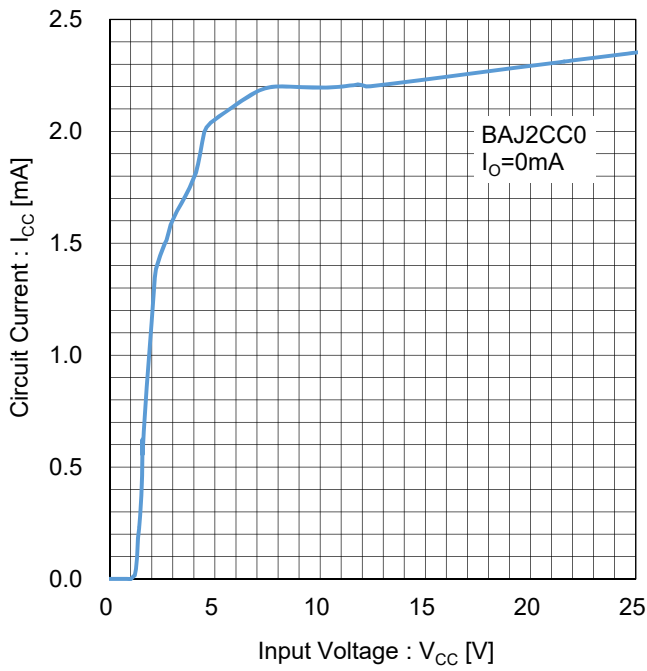


Figure 121. 回路電流  
Test Circuit A

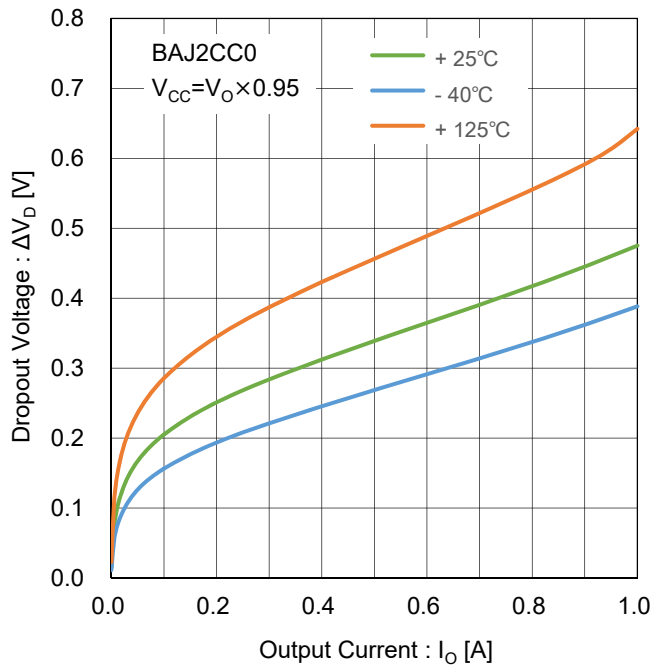


Figure 122. 最小入出力電圧差 vs 出力電流  
Test Circuit B

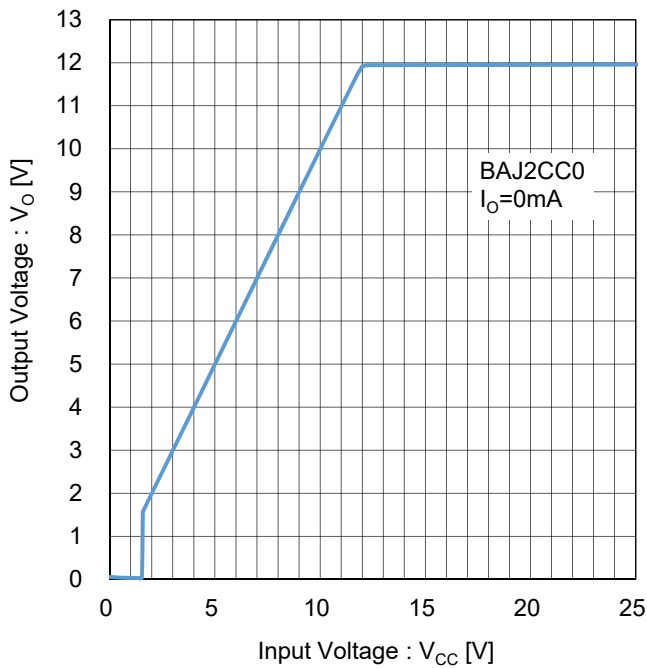


Figure 123. 出力電圧 vs 入力電圧  
( $I_o=0mA$ )  
Test Circuit C

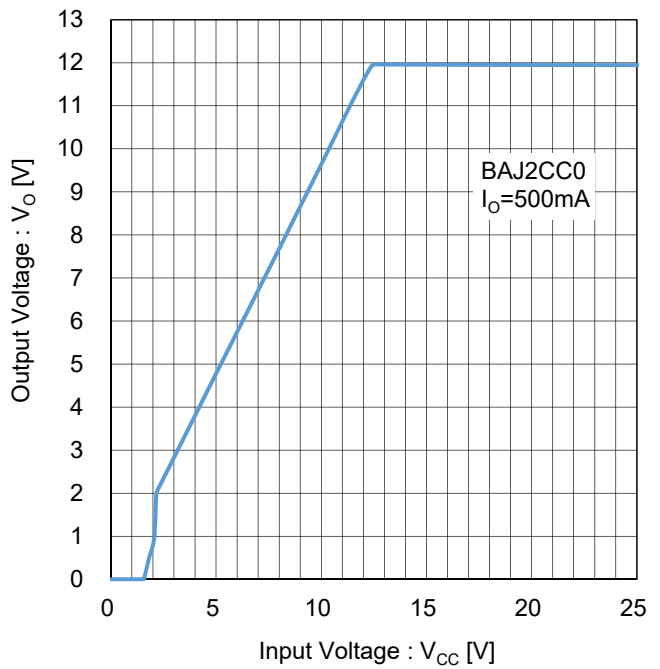


Figure 124. 出力電圧 vs 入力電圧  
( $I_o=500mA$ )  
Test Circuit C

BAJ2CC0 ( $V_o=12V$ )

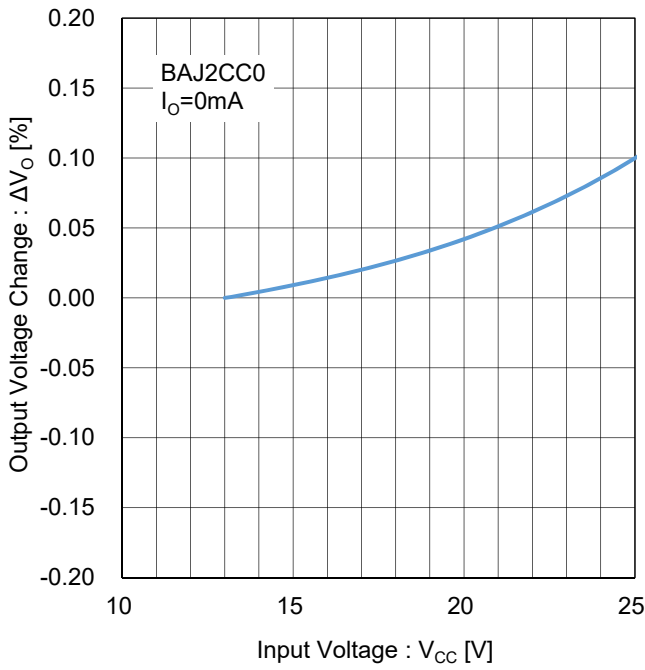


Figure 125. ラインレギュレーション  
( $I_o=0mA$ )  
Test Circuit D

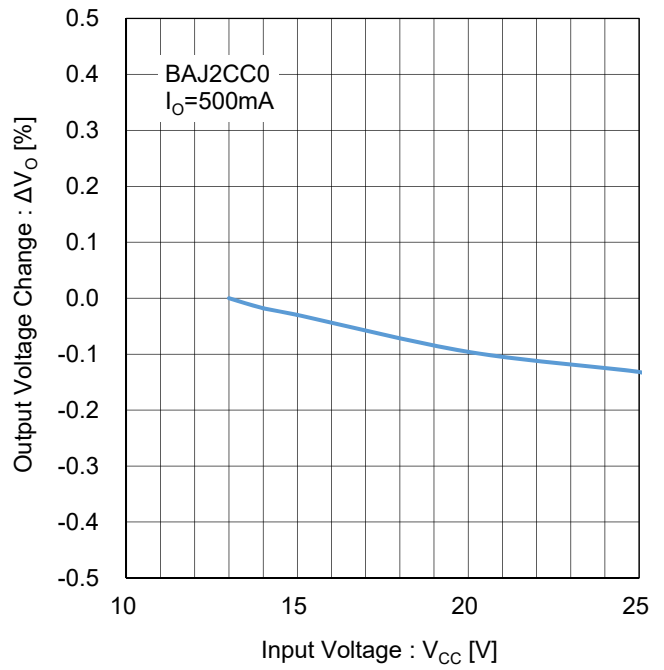


Figure 126. ラインレギュレーション  
( $I_o=500mA$ )  
Test Circuit D

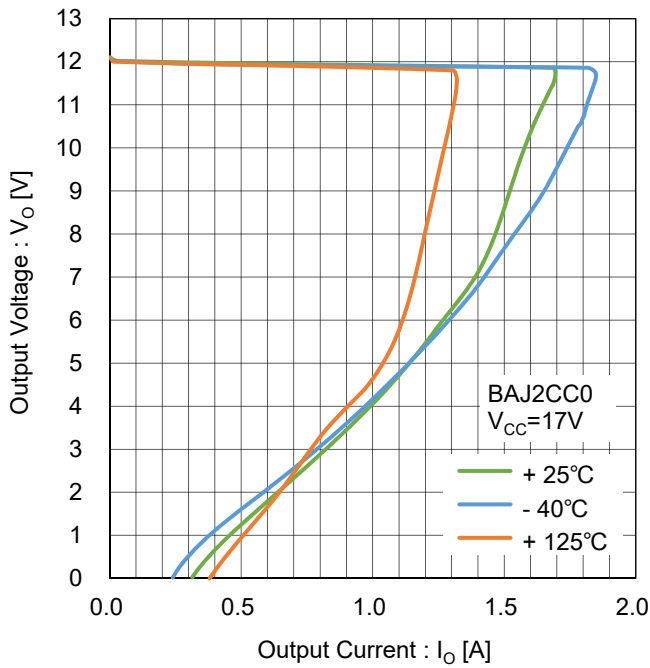


Figure 127. 過電流保護  
Test Circuit E

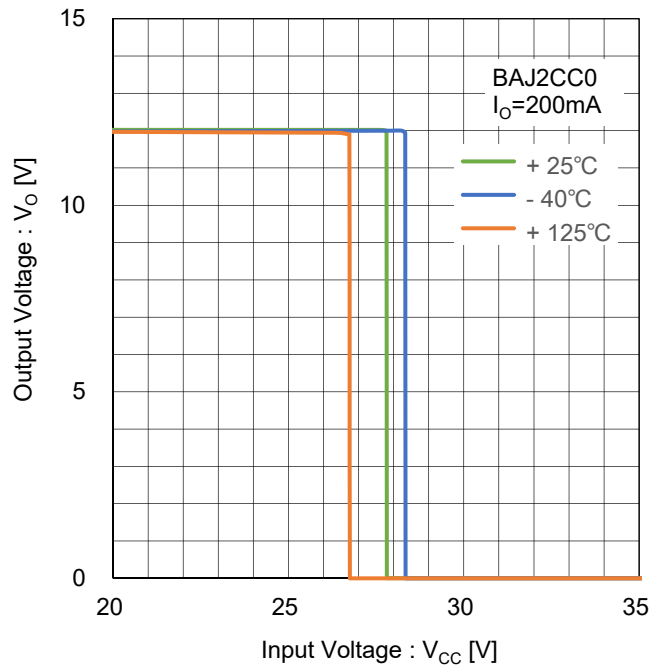


Figure 128. 過電圧動作  
Test Circuit F

BAJ2CC0 (V<sub>O</sub>=12V)

BAJ0CC0 のデータを参照

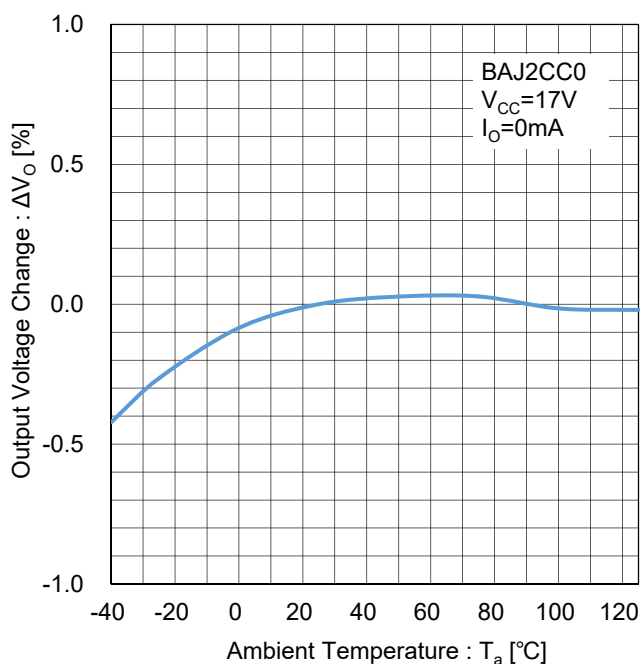


Figure 129. リップルリジェクション  
Test Circuit G

Figure 130. 出力電圧温度安定性  
Test Circuit H

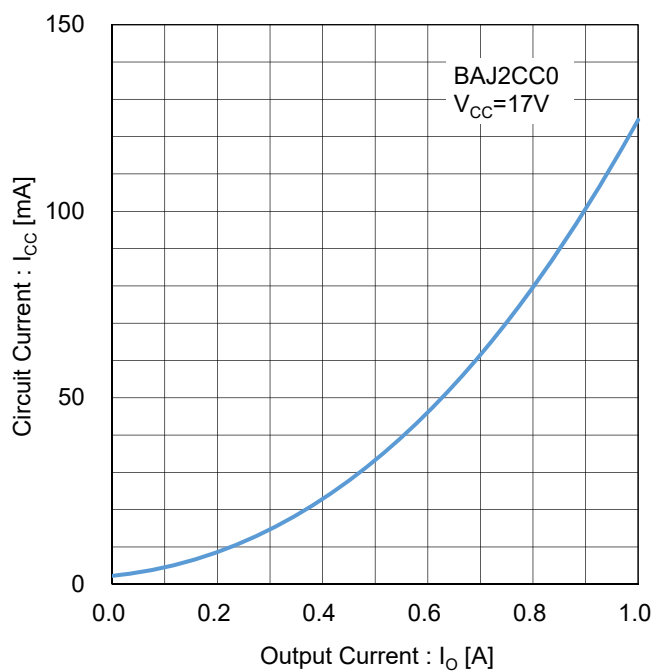


Figure 131. 回路電流 vs 出力電流  
Test Circuit I

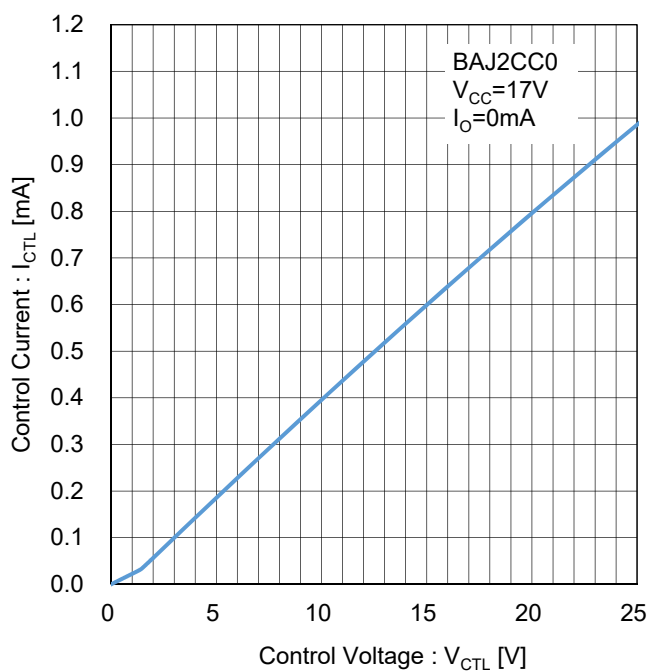


Figure 132. CTL ピン流入電流  
Test Circuit J

BAJ2CC0 ( $V_o=12V$ )

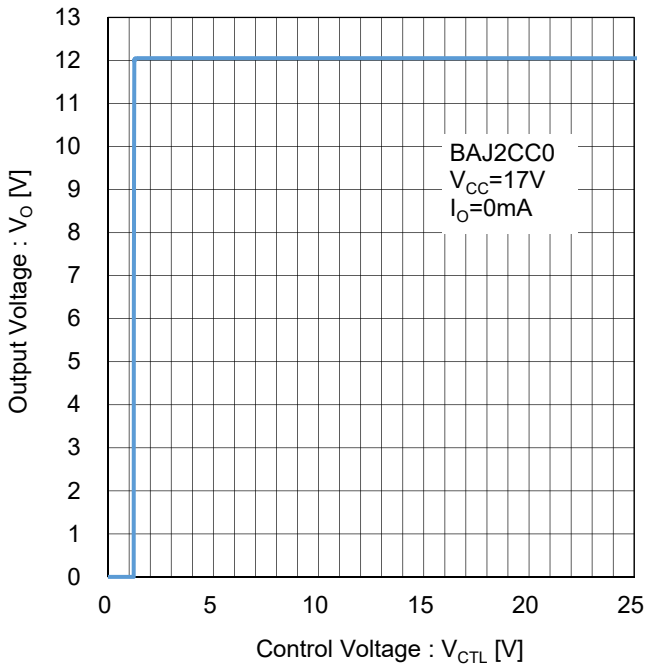


Figure 133. 出力電圧 vs CTL ピン電圧  
Test Circuit K

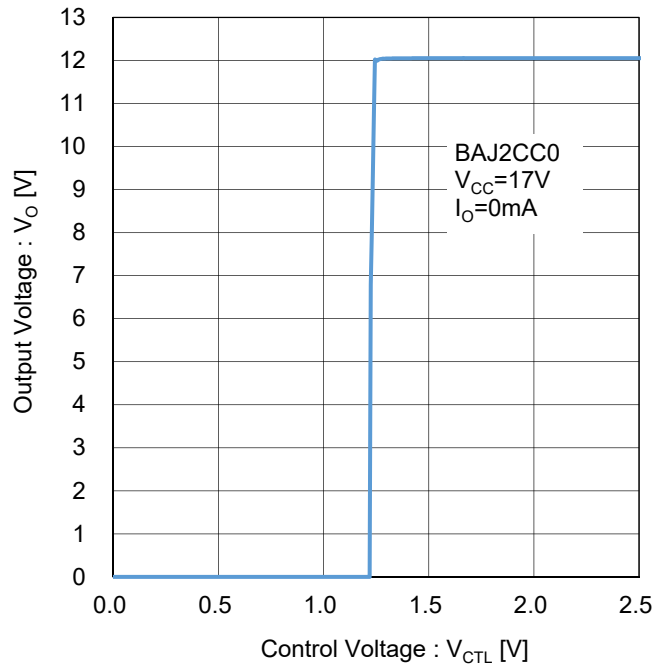


Figure 134. 出力電圧 vs CTL ピン電圧  
Test Circuit K

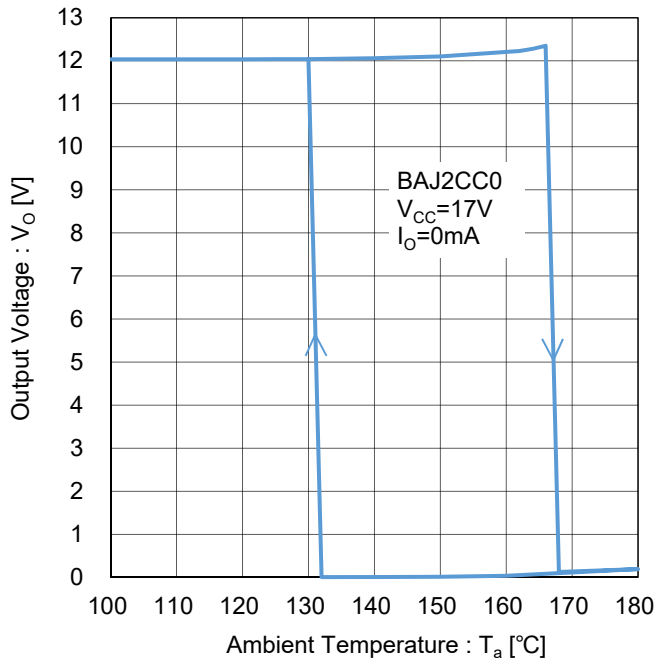


Figure 135. 過熱保護  
Test Circuit L

BAJ5CC0 ( $V_O=15V$ )

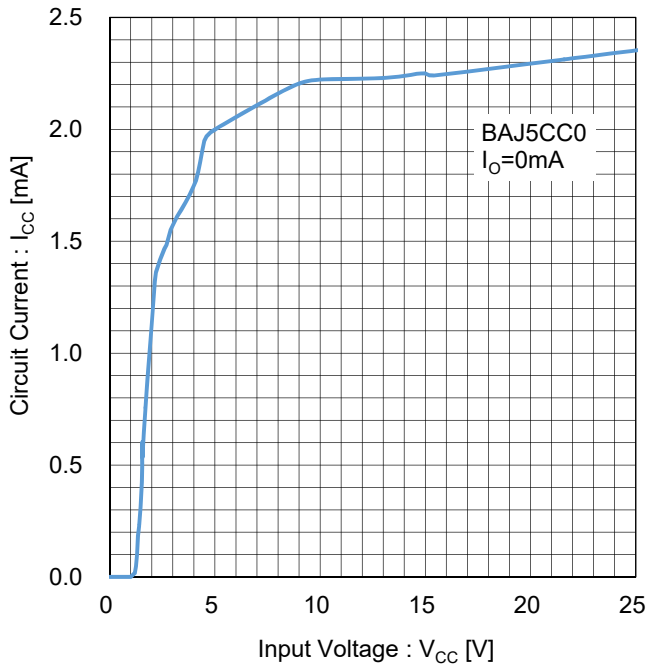


Figure 136. 回路電流  
Test Circuit A

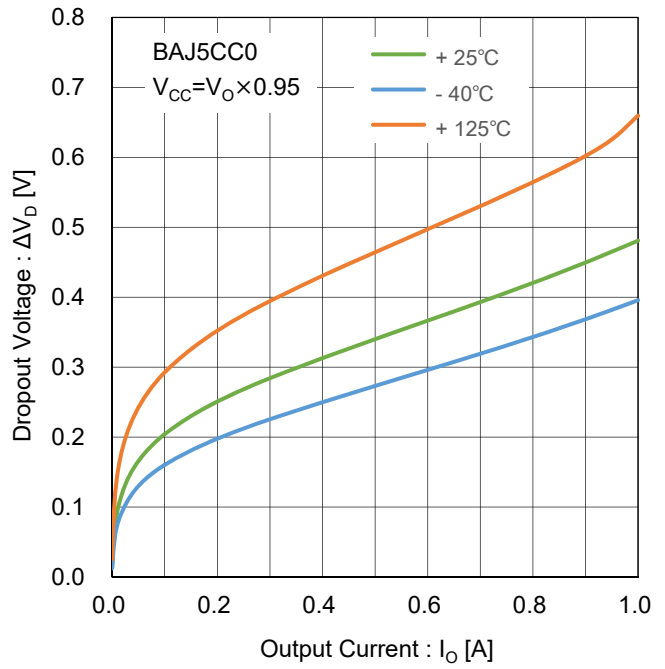


Figure 137. 最小入出力電圧差 vs 出力電流  
Test Circuit B

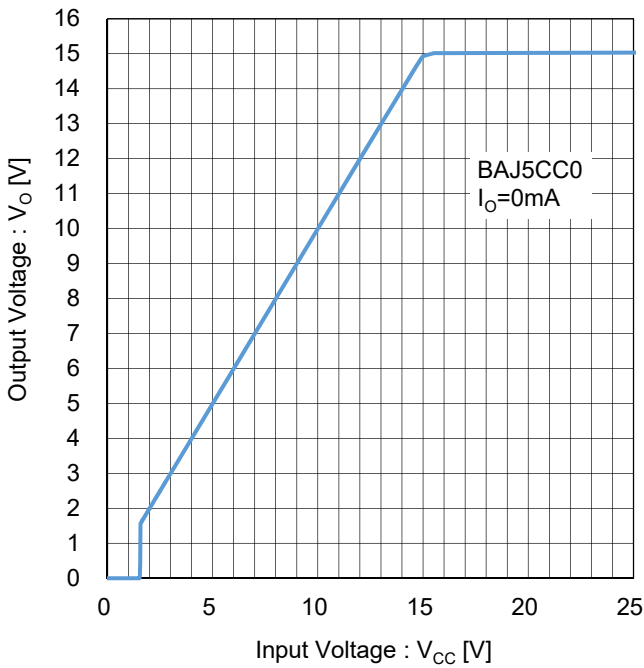


Figure 138. 出力電圧 vs 入力電圧  
( $I_o=0mA$ )  
Test Circuit C

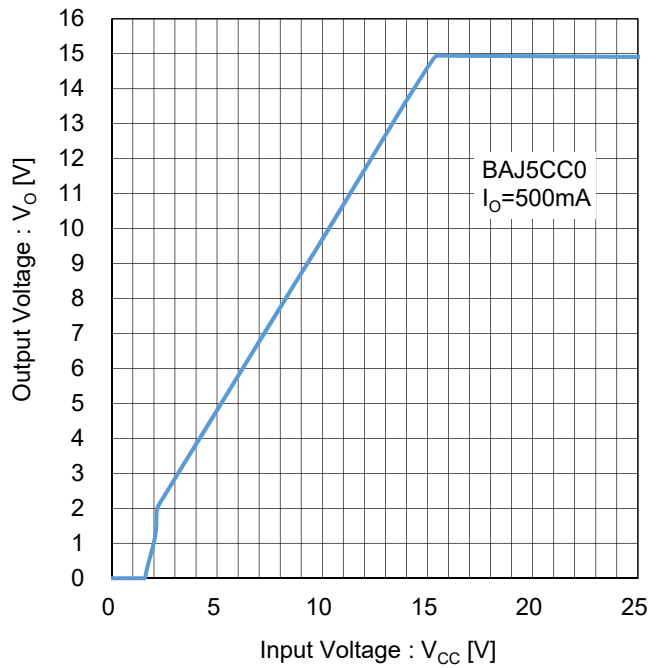


Figure 139. 出力電圧 vs 入力電圧  
( $I_o=500mA$ )  
Test Circuit C

BAJ5CC0 ( $V_o=15V$ )

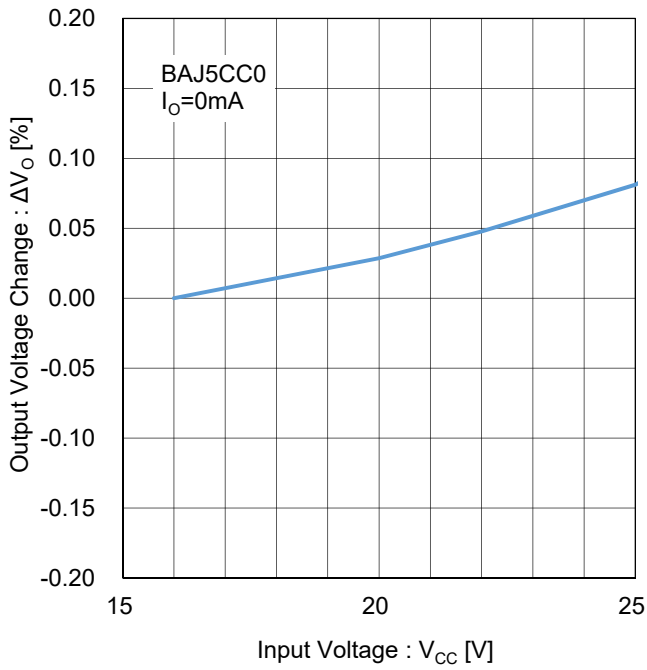


Figure 140. ラインレギュレーション  
( $I_o=0mA$ )  
Test Circuit D

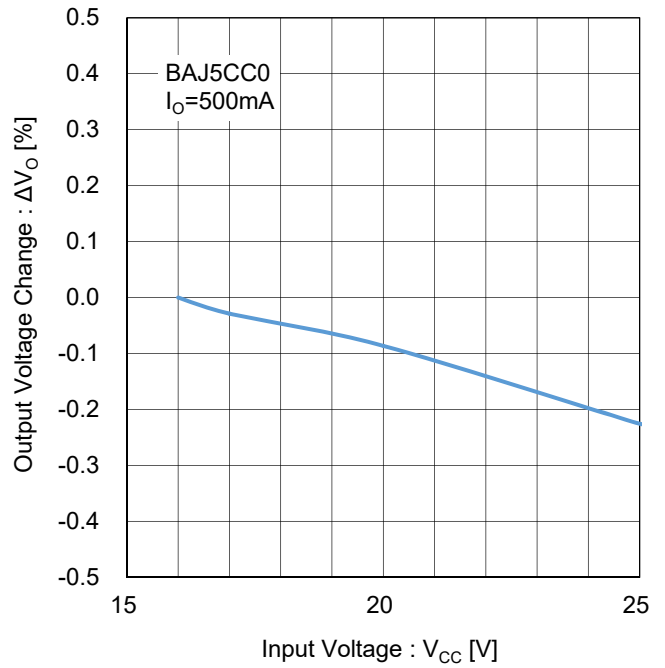


Figure 141. ラインレギュレーション  
( $I_o=500mA$ )  
Test Circuit D

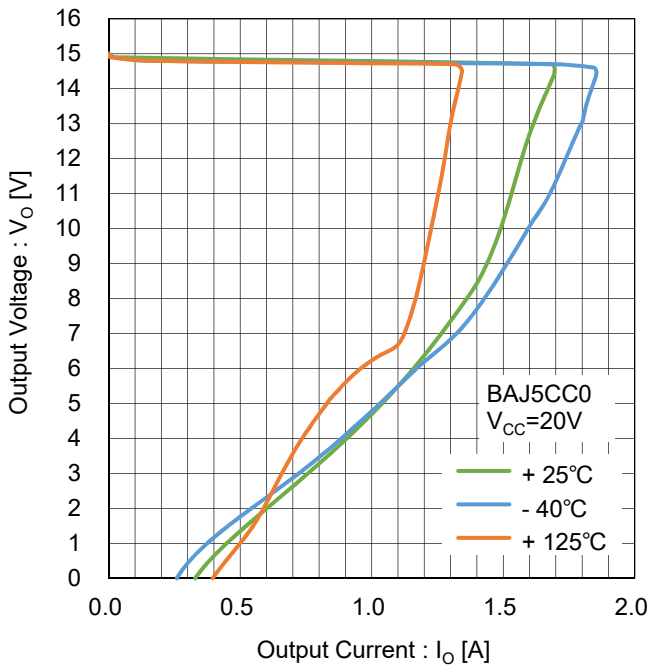


Figure 142. 過電流保護  
Test Circuit E

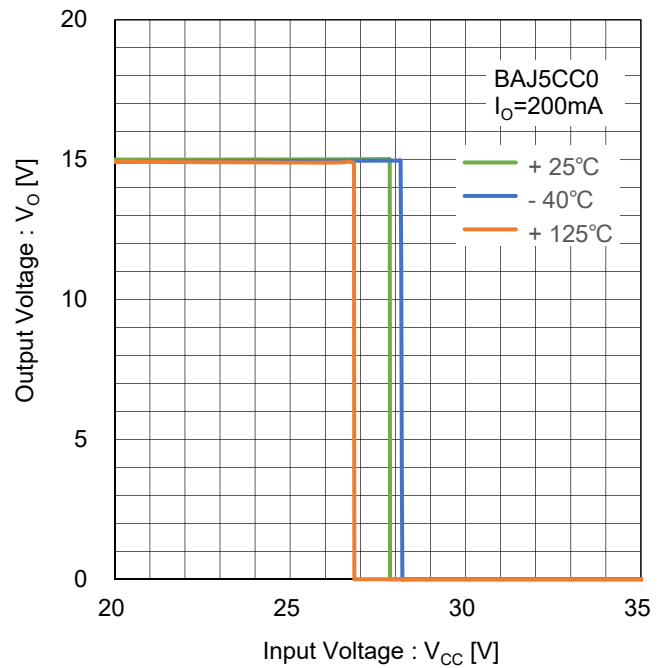


Figure 143. 過電圧動作  
Test Circuit F

BAJ5CC0 (V<sub>O</sub>=15V)

BAJ0CC0 のデータを参照

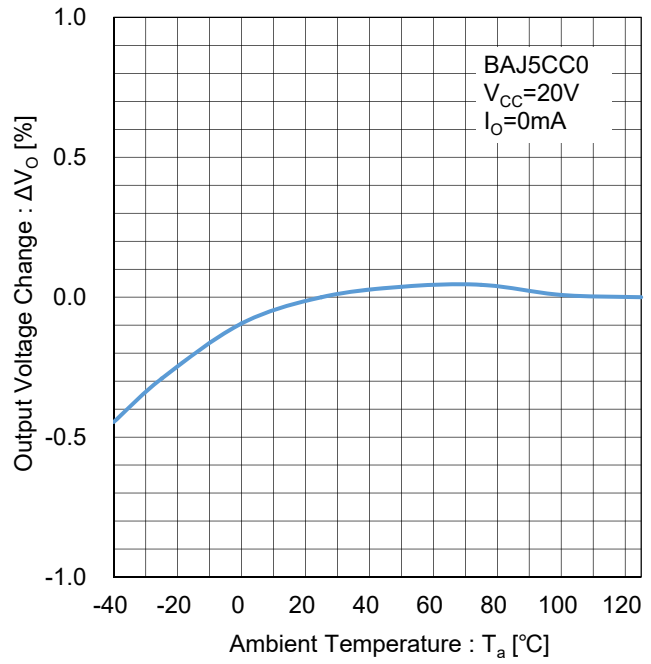


Figure 144. リップルリジェクション  
Test Circuit G

Figure 145. 出力電圧温度安定性  
Test Circuit H

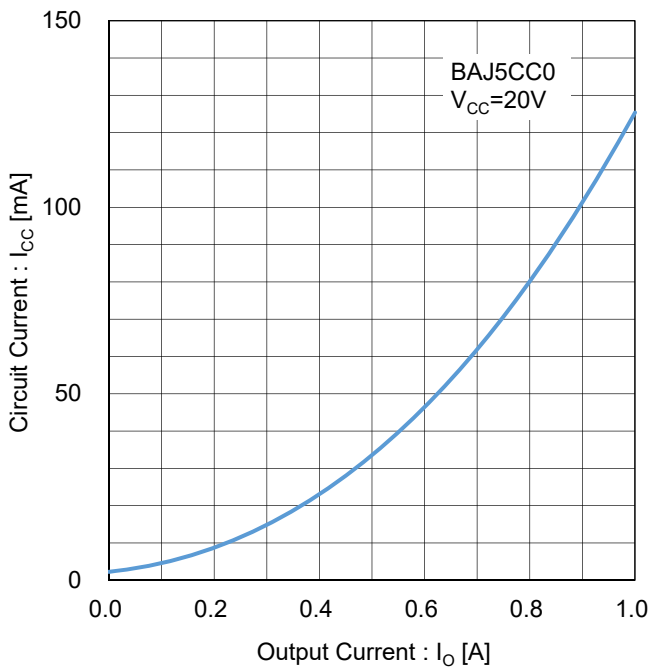


Figure 146. 回路電流 vs 出力電流  
Test Circuit I

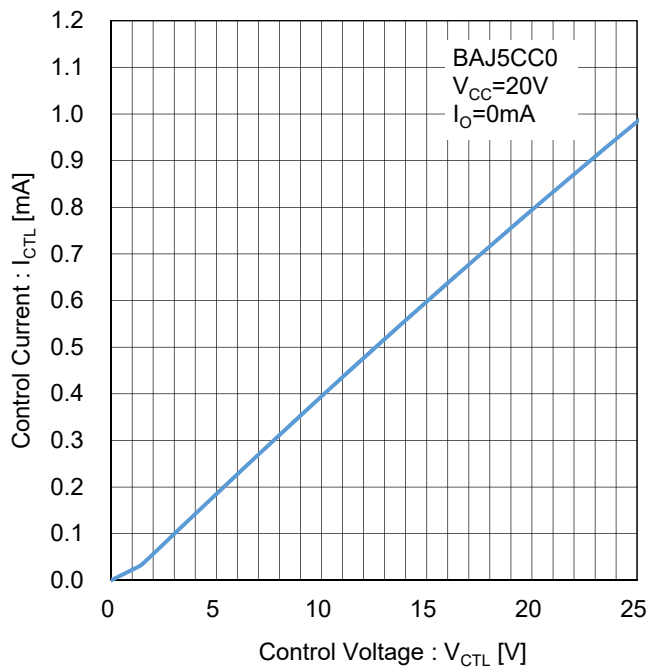


Figure 147. CTL ピン流入電流  
Test Circuit J



BAJ5CC0 ( $V_o=15V$ )

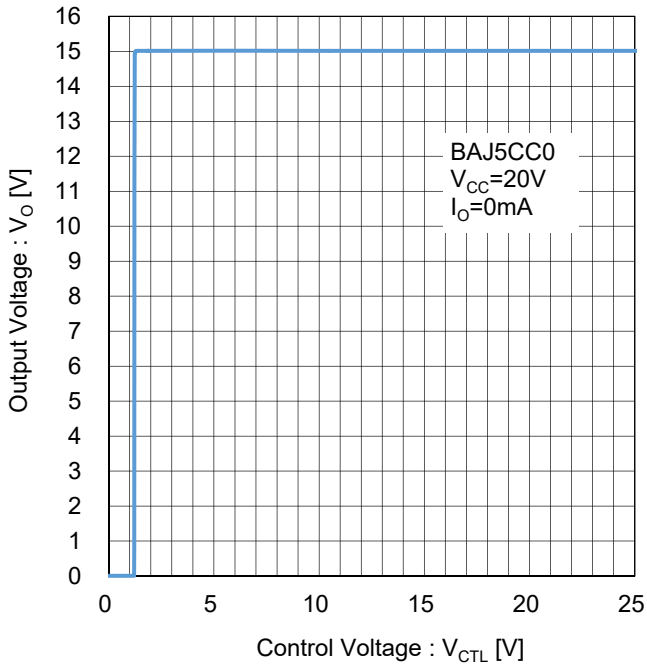


Figure 148. 出力電圧 vs CTL ピン電圧  
Test Circuit K

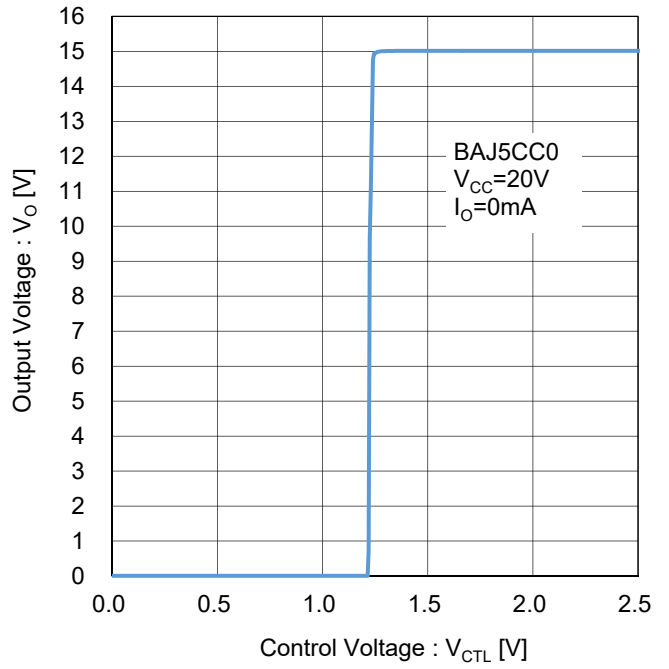


Figure 149. 出力電圧 vs CTL ピン電圧  
Test Circuit K

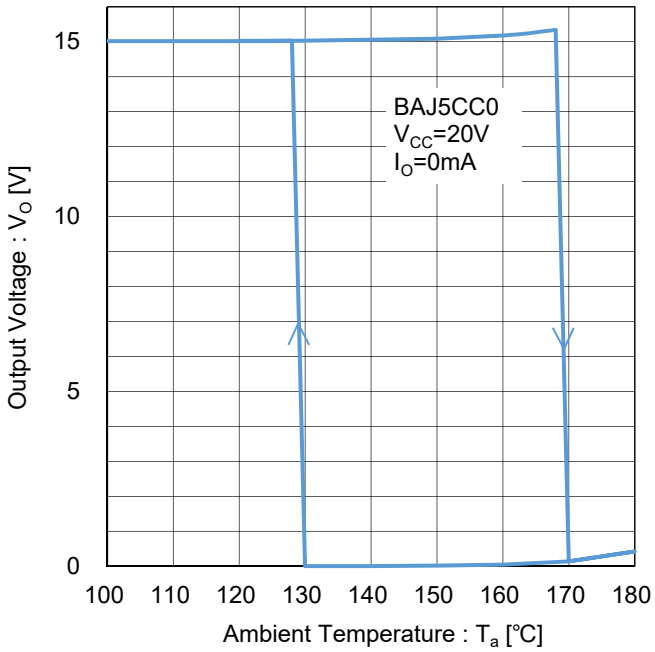
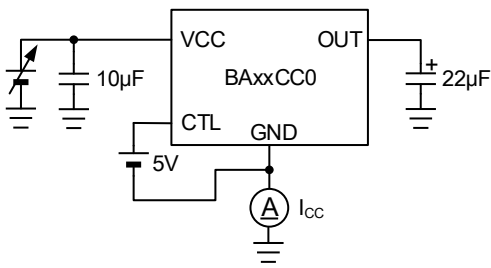
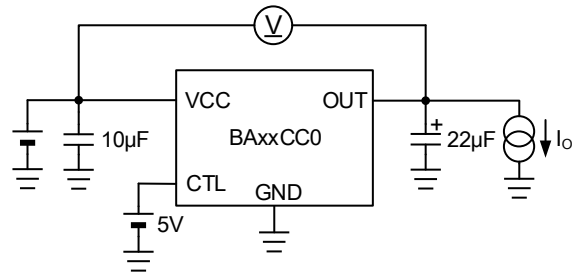


Figure 150. 過熱保護  
Test Circuit L

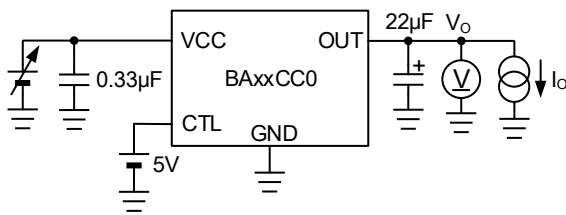
測定回路図



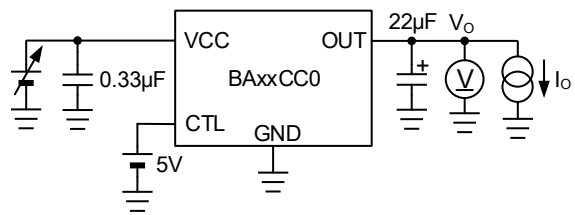
Test Circuit A. 回路電流



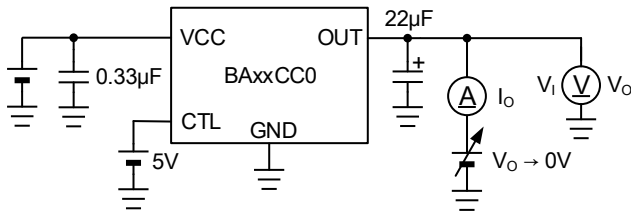
Test Circuit B. 最小入出力電圧差 vs 出力電流



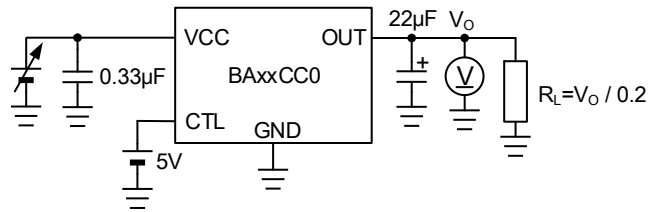
Test Circuit C. 出力電圧 vs 入力電圧



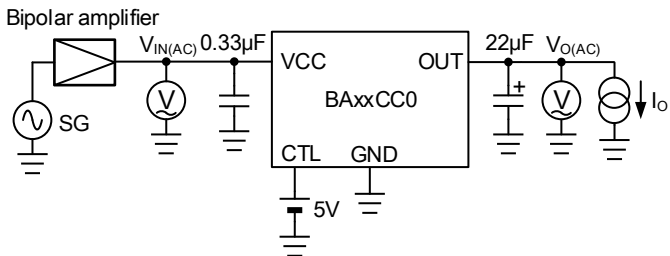
Test Circuit D. ラインレギュレーション



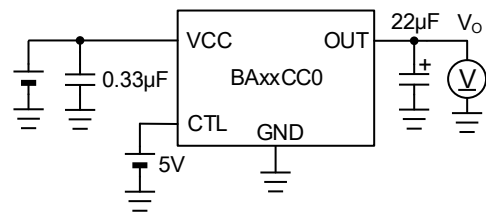
Test Circuit E. 過電流保護



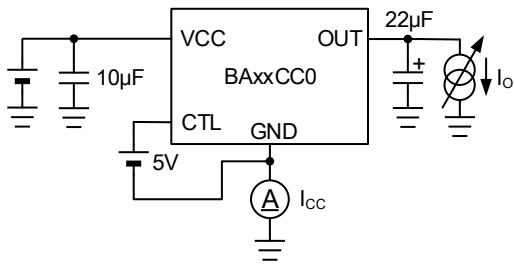
Test Circuit F. 過電圧動作



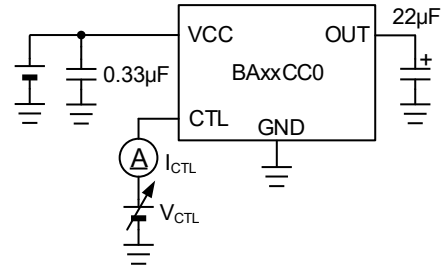
Test Circuit G. リップルリジェクション



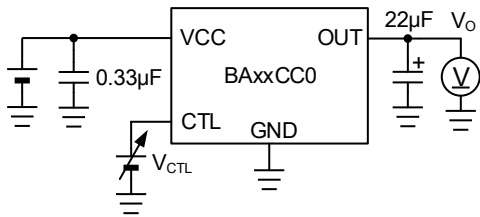
Test Circuit H. 出力電圧温度安定性



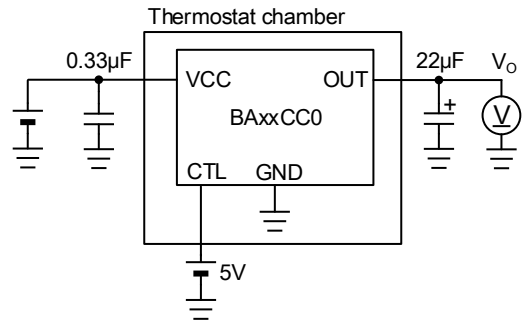
Test Circuit I. 回路電流 vs 出力電流



Test Circuit J. CTL ピン流入電流



Test Circuit K. 出力電圧 vs CTL ピン電圧



Test Circuit L. 過熱保護

## ご 注 意

- 1) 本資料の記載内容は改良などのため予告なく変更することがあります。
- 2) 本資料に記載されている内容は製品のご紹介資料です。ご使用に際しては、別途最新の仕様書を必ずご請求のうえ、ご確認ください。
- 3) ロームは常に品質・信頼性の向上に取り組んでおりますが、半導体製品は種々の要因で故障・誤作動する可能性があります。  
万が一、本製品が故障・誤作動した場合であっても、その影響により人身事故、火災損害等が起こらないようご使用機器でのディレーティング、冗長設計、延焼防止、バックアップ、フェイルセーフ等の安全確保をお願いします。定格を超えたご使用や使用上の注意書が守られていない場合、いかなる責任もロームは負うものではありません。
- 4) 本資料に記載されております応用回路例やその定数などの情報につきましては、本製品の標準的な動作や使い方を説明するものです。  
したがって、量産設計をされる場合には、外部諸条件を考慮していただきますようお願いいたします。
- 5) 本資料に記載されております技術情報は、製品の代表的動作および応用回路例などを示したものであり、ロームまたは他社の知的財産権その他のあらゆる権利について明示的にも黙示的にも、その実施または利用を許諾するものではありません。上記技術情報の使用に起因して紛争が発生した場合、ロームはその責任を負うものではありません。
- 6) 本製品は、一般的な電子機器（AV機器、OA機器、通信機器、家電製品、アミューズメント機器など）および本資料に明示した用途への使用を意図しています。
- 7) 本資料に掲載されております製品は、耐放射線設計はなされておられません。
- 8) 本製品を下記のような特に高い信頼性が要求される機器等に使用される際には、ロームへ必ずご連絡の上、承諾を得てください。  
・輸送機器（車載、船舶、鉄道など）、幹線用通信機器、交通信号機器、防災・防犯装置、安全確保のための装置、医療機器、サーバー、太陽電池、送電システム
- 9) 本製品を極めて高い信頼性を要求される下記のような機器等には、使用しないでください。  
・航空宇宙機器、原子力制御機器、海底中継機器
- 10) 本資料の記載に従わないために生じたいかなる事故、損害もロームはその責任を負うものではありません。
- 11) 本資料に記載されております情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、万が一、当該情報の誤り・誤植に起因する損害がお客様に生じた場合においても、ロームはその責任を負うものではありません。
- 12) 本製品のご使用に際しては、RoHS 指令など適用される環境関連法令を遵守の上でご使用ください。  
お客様がかかる法令を順守しないことにより生じた損害に関して、ロームは一切の責任を負いません。  
本製品の RoHS 適合性などの詳細につきましては、セールス・オフィスまでお問合せください。
- 13) 本製品および本資料に記載の技術を輸出又は国外へ提供する際には、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」など適用される輸出関連法令を遵守し、それらの定めにしたがって必要な手続を行ってください。
- 14) 本資料の一部または全部をロームの許可なく、転載・複写することを堅くお断りします。



ローム製品のご検討ありがとうございます。  
より詳しい資料やカタログなどご用意しておりますので、お問合せください。

ROHM Customer Support System

<http://www.rohm.co.jp/contact/>